



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของความต้มดอทโดยใช้วิธีเดดอทพี

โดย

นายวรศักดิ์ สุขบท

5 กุมภาพันธ์ 2557



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของควอนตัมดอทโดยใช้วิธีเค朵อพี

Electronic structure and optical properties of Quantum Dots: k.p method

ผู้วิจัย

นายวรศักดิ์ สุขบท

สังกัด

ภาควิชาฟิสิกส์

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2555

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย ม.อ.บ. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

คำนำ

งานวิจัยเรื่อง สมบัติทางโครงสร้างและแสงของควอนตัมคอทโคปไฮบริดเคดอฟพี (Electronic structure and optical properties of Quantum Dots: k.p method) ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นงานวิจัยในเชิงทฤษฎีที่ศึกษาสมบัติทาง โครงสร้างและแสงของควอนตัมคอท โดยประยุกต์ใช้การแก๊ส喻หาโดยวิธีเคดอฟพี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการประดิษฐ์วัสดุทางอิเล็กทรอนิก เข่น ทราบชิสเตอร์ เลเซอร์ และ เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้จะสามารถนำไปประยุกต์และมีประโยชน์ในอนาคต

นายวรศักดิ์ สุขบพ

ผู้วิจัย

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อโครงการวิจัย	การศึกษาสมบัติทาง โครงสร้างและแสงของความตันดอนที่โดยใช้วิธีเคคอฟฟี่
ผู้วิจัย	วรศักดิ์ สุขนท
ที่ทำงาน	ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะเวลาทำการวิจัย	มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556

ความเป็นมา/ปัญหาในการวิจัย

ในปัจจุบันการศึกษาอนุภาคในระดับนาโนเมตร ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยสมบัติโครงสร้างทางฟิสิกส์และเคมีที่แตกต่างและ โดดเด่นของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ทำให้สามารถประยุกต์ใช้คุณสมบัติังกล่าวในทางอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ ความตันดอนที่ (Quantum Dots) เป็นโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในช่วงทศวรรษนี้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทางแสง ตัวอย่างเช่น ตัวตรวจจับทางแสง (Light detector), ไดโอดปลั่งแสง (Light emitting diode), โซลาร์เซลล์ (Solar cell), เลเซอร์ (Laser) เป็นต้น นอกจากนี้ความตันดอนที่ยังได้ถูกศึกษาในด้านความตันคอมพิวติง (Quantum Computing) ซึ่งจะถูกพัฒนาต่อขดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลที่รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้ได้มีการศึกษาสมบัติของความตันดอนที่ขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในด้านทฤษฎีและการทดลอง

ในด้านการทดลอง งานวิจัยได้ทำการปลูกความตันดอนที่โดยใช้วิธี Stanski Krastanov ซึ่งอาศัยคุณสมบัติความเครียดที่เกิดจากสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิดมาประกอบกัน จนก่อให้เกิดเป็นอนุภาคความตันดอนที่ขึ้น ส่วนรูปร่างของความตันดอนจะใช้เครื่อง Atomic Force Microscopy (AFM) ในการพิจารณาและวิเคราะห์ นอกจากการปลูกความตันดอนแล้ว งานวิจัยยังศึกษาคุณสมบัติทางแสงของความตันดอนโดยใช้เครื่อง Photoluminescence Spectroscopy ขณะที่งานวิจัยในเชิงทฤษฎีสร้างแบบจำลอง (Model) ขึ้น โดยอาศัยตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ ที่สอดคล้องกับการทดลอง เช่น สารกึ่งตัวนำที่นำมาสังเคราะห์ความตันดอน, รูปร่างและขนาดของอนุภาคความตันดอน เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะคำนวณหาระดับพลังงานภายในความตันดอน ในปัจจุบันนี้มีทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานกันอย่างแพร่หลาย เช่น วิธีไทด์บันด์ดิ้ง (Tight-Binding) วิธีซูโดโพเทนเชียล (Pseudopotential) วิธีดีอีฟฟี่ (DFT) วิธีเคคอฟฟี่ (k.p) เป็นต้น หลังจากนั้น ก็นำแบบจำลองดังกล่าวไปดำเนินการในเชิงทฤษฎีที่ทำนายคุณสมบัติต่างๆ ของอนุภาคความตันดอน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ดังนั้นจะเห็นว่างานวิจัยในเชิงทฤษฎีที่ทำนายคุณสมบัติต่างๆ ของอนุภาคความตันดอน เมื่อได้คุณสมบัติที่ต้องการแล้ว งานวิจัยทางด้านการทดลองก็จะดำเนินการต่อเพื่อยืนยันผลงานวิจัยและได้ผลิตภัณฑ์ออกมา จากนั้นจึงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่อไป

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทาง โครงสร้างและแสงของความตันดอนในเชิงทฤษฎีโดยใช้วิธีเคคอฟฟี่ (k.p) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากความตันดอนนี้ถูกสังเคราะห์จากสาร 2 ชนิดที่มีความยาวของโครงสร้างทางผสานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเกิดความเครียดขึ้นภายในและรอบๆ ความตันดอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution) ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณนั้น การศึกษาคุณสมบัติทางแสงของความตันดอนเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สำหรับที่ใช้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติังกล่าว เช่น สเปกตรัมการปลั่งแสง (Emission spectrum)

การถ่ายโอนระดับพลังงานภายในควอนตัมคอท (Optical transition) เป็นคัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลองอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- ศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างของควอนตัมคอทโดยใช้วิธีเคคอฟฟี่ เช่น ความเครียด รูปร่างและขนาดของควอนตัมคอทศึกษาคุณสมบัติทางแสงของควอนตัมคอทโดยใช้วิธีเคคอฟฟี่ เช่น สเปกตรัมการเปล่งแสง การเปลี่ยนถ่ายระดับพลังงานภายในควอนตัมคอท เป็นคัน
- เปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้รับในเชิงทฤษฎีกับผลการทดลอง

วิธีดำเนินการวิจัย

- สถานที่ทำการทดลองและเก็บข้อมูลอยู่ที่ กลุ่มวิจัย Quantum Dot ที่อาคารภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ค้นคว้าบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมคอททั้งในเชิงทฤษฎีและการทดลอง
- ทำการวิจัยตามแผนงานที่วางไว้โดยใช้คอมพิวเตอร์ทำงานวิจัยและเปรียบเทียบผลการคำนวณกับการทดลองดังแผนการดำเนินงานในข้อ 3.1-3.4 ดังแสดงในบทที่ 3
- รายงานผลงานวิจัยในรูปของบทความงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

ผลการวิจัย/ข้อค้นพบ

ผู้จัดได้อธิบายการกระจายตัวของความเครียดในควอนตัมคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว โดยระบุห่างระหว่างควอนตัมคอทอยู่ในช่วง 0-6 นาโนเมตร โดยประยุกต์วิธี elastic continuum theory ในคำนวณการกระจายตัวของความเครียด ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานอันเนื่องมาจากความเครียดโดยวิธี eight-band strain-dependent k.p จากผลการคำนวณพบว่ามีการบีบตัวภายในบริเวณควอนตัมคอท () เมื่อห่างระหว่างควอนตัมคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัวเพิ่มขึ้น ความเครียดแบบ biaxial ทั้งในบริเวณควอนตัมคอทและบริเวณรอบๆ จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการคำนวณพบว่าความเครียดแบบ hydrostatic และ ความเครียดแบบ biaxial สามารถใช้ในการพิจารณาฐานรากแบบของแบบพลังงาน ความเครียดแบบ hydrostatic จะยกระดับพลังงานค่อนคักชันและเวลenuซึ่นจะมีความเครียดแบบ biaxial จะทำให้แบบพลังงาน เวลenuซึ่นจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน มีค่าต่างกัน เมื่อพิจารณาความเครียด ศุลกากร ความเครียดและระยะห่างระหว่างควอนตัมคอทส่งผล กระทบอันสำคัญต่อรูปร่างและระดับของแบบพลังงานในควอนตัมคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของการกระจายตัวของความเครียดและปรากฏการณ์ Piezoelectricity ในเชิงทฤษฎีโดยวิธีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (continuum elasticity) และเคคอฟฟี่ ผลการคำนวณแสดงว่า การกระจายตัวของความเครียดและปรากฏการณ์ Piezoelectricity มีอิทธิพลอย่างมากต่อโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของควอนตัมคอท โดยความเครียดจะยกระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและ ไฮโลเมื่อเทียบกับการคำนวณที่ไม่ได้พิจารณาความเครียด ในขณะที่ พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการประยุกต์ Piezoelectricity ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอน ระดับพลังงานที่ 1 () แต่จะส่งผลให้เกิดการกลับทิศทางการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ 2 และ 3 (และ) จาก [] เป็น [110] และในทางกลับกัน ในส่วนของสถานะ ไฮโล Piezoelectricity ทำให้วางตัวของฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับฟังก์ชันคลื่นที่ไม่ได้พิจารณา Piezoelectricity ในการคำนวณ

ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมในเรื่องอัตราการห่วงโซ่อิเล็กตรอนและโอล ภายในความตันคอม (Electron-hole interaction in Quantum dots) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาเซลล์สุริยะ (Solar cell)
2. งานวิจัยนี้สามารถต่อยอดในการประยุกต์ความตันคอมในการศึกษาปรากฏการณ์ Polarization ภายในความตันคอม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษา Quantum Computer

การนำไปใช้ประโยชน์

1. สามารถนำแบบจำลองนี้ไปทำนายสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากอนุภาคความตันคอม เช่น ไคโอดีปัลจังแสง เลเซอร์ โซลาร์เซลล์ เป็นต้น
2. เผยแพร่วิจัยในรูปแบบของการนำเสนอผลงานในที่ประชุมและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะของตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ต่อยอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบของโครงการพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท-เอก

ชื่อเรื่อง: การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแสงของความต้านคัดท่อไนโตรเจโนฟฟ์
ผู้วิจัย: วรศักดิ์ สุขุม (Ph.D.) ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่: 2555

บทคัดย่อ

แสดงการคำนวณ โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และการกระจายตัวของความเครียดสำหรับ InAs/GaAs ความต้านคัด การคำนวณการกระจายตัวของความเครียดอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีขีดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง (continuum elastic theory) การคำนวณศักย์เพียงไซอิเล็กทริก (Piezoelectric potential) โดยการหาผลเฉลยของสมการพื้นชั้ง 3 มิติ คำนวณระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและหลุนของ InAs/GaAs ความต้านคัดที่ได้โดยวิธีเคโคทพี (k.p method) ที่จัดเตรียมไว้ให้ ผลการคำนวณแสดงผลกรอบของความเครียดและเพียงไซอิเล็กทริก

คำสำคัญ: ความต้านคัด, เคโคทพี

Title: **Electronic structure and optical properties of Quantum Dots: k.p method**

Author: **Worasak Sukkabot (Ph.D.) Department of Physics, Faculty of Science,
Ubon Ratchathani University**

Year of Publication: **2555**

Abstract

The calculations of the electronic structure and strain distribution for self-organized InAs/GaAs quantum dots are presented. The strain calculations are based on the continuum elastic theory. The piezoelectric potential is calculated by solving the 3D Poisson's equation. The electron and hole energy levels of the InAs/GaAs quantum dots are calculated by implementing the k.p method. The calculated results show the importance of strain and piezoelectric effects.

Keywords: Quantum dot, k.p method

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	I
บทคัดย่อ	IV
Abstract	V
บทที่ 1	1
บทที่ 2	4
บทที่ 3	8
บทที่ 4	10
บทที่ 5	16
บทที่ 6	24
บรรณานุกรม	25
ภาคผนวก ก บทความจำแนกวิจัย	26
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบวัดถุประสงค์	27
ภาคผนวก ค รายงานการเงิน	28

บทที่ 1

ความสำคัญและที่มา

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ในปัจจุบันการศึกษาอนุภาคในระดับนาโนเมตร ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยสมบัติโครงสร้างทางพิสิกส์ และเคมีที่แตกต่างและโดดเด่นของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ทำให้สามารถประยุกต์ใช้คุณสมบัติดังกล่าวในทางอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ ควอนตัมคอท (Quantum Dots) เป็นโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในช่วงทศวรรษนี้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทางแสง ตัวอย่างเช่น ตัวตรวจจับทางแสง (Light detector), ไดโอดเปล่งแสง (Light emitting diode), โซลาร์เซลล์ (Solar cell), เลเซอร์ (Laser) เป็นต้น นอกจากนี้ ควอนตัมคอทยังได้ถูกศึกษาในด้านควอนตัมคอมพิวติ๊ง (Quantum Computing) ซึ่งจะถูกพัฒนาต่อขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลที่รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้ได้มีการศึกษาสมบัติของควอนตัมคอทขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในด้านทฤษฎีและการทดลอง

ในด้านการทดลอง งานวิจัยได้ทำการปลูกควอนตัมคอทโดยใช้วิธี Stanski Krastanov ซึ่งอาศัยคุณสมบัติความเครียดที่เกิดจากสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิดมาประกอบกัน จนก่อให้เกิดเป็นอนุภาคควอนตัมคอทขึ้น ส่วนรูปร่างของควอนตัมคอทจะใช้เครื่อง Atomic Force Microscopy (AFM) ในการพิจารณาและวิเคราะห์ นอกจากการปลูกควอนตัมคอทแล้ว งานวิจัยยังศึกษาคุณสมบัติทางแสงของควอนตัมคอทโดยใช้เครื่อง Photoluminescence Spectroscopy ขณะที่งานวิจัยในเชิงทฤษฎีจะสร้างแบบจำลอง (Model) ขึ้นโดยอาศัยตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ ที่สอดคล้องกับการทดลอง เช่น สารกึ่งตัวนำที่นำมาสังเคราะห์ควอนตัมคอท รูปร่างและขนาดของอนุภาคควอนตัมคอท เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะคำนวณหาระดับพลังงานภายในควอนตัมคอท ในปัจจุบันนี้ มี方法วิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานกันอย่างแพร่หลาย เช่น วิธีไทด์บายด์ดิ้ง (Tight-Binding) วิธีซูโดโพเทนเชียล (Pseudopotential) วิธีดีอีฟที (DFT) วิธีเคโคทพี (k.p) เป็นต้น หลังจากนั้นก็นำแบบจำลองดังกล่าวไปทำนายคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของอนุภาคควอนตัมคอท พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ดังนั้นจะเห็นว่างานวิจัยในเชิงทฤษฎีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องของอนุภาคควอนตัมคอท เมื่อได้คุณสมบัติที่ต้องการแล้ว งานวิจัยทางด้านการทดลองก็จะดำเนินการต่อเพื่อยืนยันผลงานงานวิจัยและได้ผลลัพธ์ที่ออกมารากันนั้นจริงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่อไป

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแสงของควอนตัมคอทในเชิงทฤษฎีโดยใช้วิธีเคโคทพี (k.p) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากควอนตัมคอทนั้นถูกสังเคราะห์จากสาร 2 ชนิดที่มีความขาวของโครงสร้างทางพล็อกที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเกิดความเครียดขึ้นภายในและรอบๆ ควอนตัมคอท ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution) ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณนั้น การศึกษาคุณสมบัติทางแสงของควอนตัมคอทเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์นำแสงที่ใช้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดังกล่าว เช่น สเปกตรัมการเปล่งแสง (Emission spectrum) การถ่ายโอนระดับพลังงานภายในควอนตัมคอท (Optical transition) เป็นต้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลองอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. ศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างของความตันคอทโดยใช้วีวีเคอทพี เช่น ความเครียด รูปร่างและขนาดของความตันคอทศึกษาคุณสมบัติทางแสงของความตันคอทโดยใช้วีวีเคอทพี เช่น สเปกตรัมการเปล่งแสง การเปลี่ยนถ่ายระดับพลังงานภายในความตันคอท เป็นต้น
2. เปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้รับในเชิงทดลองกับผลการทดลอง

ขอบเขตของโครงการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของความตันคอทในกุ่ม III-V ของสารกึ่งตัวนำโดยใช้วีวีเคอทพีในการคำนวณ สมบัติที่จะศึกษาได้แก่ การกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution) ระดับพลังงานที่อยู่ภายในความตันคอท (Energy levels) และสมบัติทางแสงของความตันคอท (Optical properties) เช่น โพลาร์ไลเซชัน (Polarization) การถ่ายโอนระดับพลังงานภายในความตันคอท (Optical transition) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลองอีกด้วย

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบัน งานวิจัยทางด้านความตันคอทแบ่งออกเป็น 2 แขนงตามวิธีการวิจัย ได้แก่ งานวิจัยทางด้านการทดลอง และทดลอง ในงานวิจัยทางด้านการทดลอง นักวิจัยได้ทำการปลูกความตันคอทโดยใช้วีวี Stanski Krastanov ส่วนรูปร่าง และขนาดของความตันคอทจะใช้เครื่อง Atomic Force Microscopy (AFM) ในการพิจารณาและวิเคราะห์ โดยที่รูปร่างของอนุภาคความตันคอทส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเป็น พิระมิด ขนาดของอนุภาคความตันคอทจะมีขนาดตั้งแต่ 10-100 นาโนเมตร ขึ้นอยู่กับสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในการสังเคราะห์และสภาพแวดล้อมในการปลูกความตันคอท ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเลือกขนาดของอนุภาคความตันคอทในช่วง 10-30 นาโนเมตร เนื่องมาจาก ในช่วงดังกล่าวได้มีการสังเคราะห์อนุภาคความตันคอทอย่างแพรวพราวและยังนำไปประยุกต์ในการศึกษาสมบัติทางแสงของความตันคอทโดยใช้เครื่อง Photoluminescence Spectroscopy เพื่อศึกษาการถ่ายโอนพลังงานภายในความตันคอท ขณะที่งานวิจัยในด้านนี้ยังศึกษาคุณสมบัติทางแสงของความตันคอทโดยใช้เครื่อง Photoluminescence Spectroscopy เพื่อศึกษาการถ่ายโอนพลังงานภายในความตันคอท ขณะที่งานวิจัยในเชิงทดลองแบบจำลอง (Model) ขึ้นโดยอาศัยตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ ที่สอดคล้องกับการทดลอง เช่น สารกึ่งตัวนำที่นำมาสังเคราะห์ความตันคอท รูปร่าง และขนาดของอนุภาคความตันคอท เป็นต้น เพื่อที่จะคำนวณหาระดับพลังงานภายในความตันคอท ในปัจจุบันนี้มีหลายวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานกันอย่างแพรวพราว เช่น วิธีไทด์บันยาดีดิ้ง (Tight-Binding) มีกุ่มวิจัยของ Prof. Gerhard Klimeck ที่ University of Purdue ได้พัฒนา software และทำการวิจัยในเรื่องนี้ วิธีซูโดโพเทนเชียล (Pseudopotential) มีกุ่มวิจัยที่ National Renewable Energy Laboratory ของ Prof. Alex Zunger ศึกษาความตันคอทโดยใช้วีวีน้อย วีวีเคอทพี (k.p) ก็มีกุ่มวิจัยของ Prof. Bimberg ทำการศึกษาอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น หลังจากนั้นก็มีแบบจำลอง ดังกล่าวไปท่านายคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของอนุภาคความตันคอท พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแสงของความตันคอทในเชิงทดลองโดยใช้วีวีเคอทพี (k.p) ที่ได้รับการพัฒนาจากกุ่มวิจัยของ Prof. Shun-Jen Cheng ที่ National University of Chiao Tung ประเทศไทย ได้ทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของความตันคอท
2. เปรียบเทียบผลการคำนวณจากแบบจำลองของผู้วิจัยกับผลการทดลอง
3. สามารถประยุกต์ผลการวิจัยนี้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำเป็นวัตถุคิน

4. เพย์พร์งานวิจัยในรูปแบบของการนำเสนอผลงานในที่ประชุมและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
5. ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบของโครงการพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท-เอก

บทที่ 2
ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution)

ตำแหน่งของอะตอมที่อยู่ภายในและรอบ ๆ อนุภาคความตั้มดอทสามารถอธิบายในโครงสร้างของ supercell of the Face-centered cubic เนื่องจากความแตกต่างกันของ Lattice constant ระหว่างความตั้มดอทและอะตอมที่อยู่ภายในและรอบ ๆ ความตั้มดอท ความเครียดจึงเกิดขึ้นในโครงสร้างนี้ ในขณะที่มี 2 วิธีในการศึกษาความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นคือ Continuum elasticity และ Valence force field (VFF) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ Continuum elasticity เนื่องจากสามารถศึกษาความเครียดที่เกิดขึ้นกับอนุภาคความตั้มดอทที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ผลกระทบของพลังงานอันเนื่องมาจากการกระจายตัวของความเครียดเท่ากับ

$$U_{CE} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} C_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl}$$

พิจารณาอนุภาคความตั้มดอท ค่า U_{CE} สามารถหาได้จากการทำให้ขนาดของ U_{CE} มีค่าน้อยที่สุดโดยประยุกต์วิธี Finite difference ค่าความเครียด ε_{ij} ตามแนว i และ j สามารถหาได้จาก $\varepsilon_{ij} = \left(\frac{du_i}{dx_j} + \frac{du_j}{dx_i} \right) / 2$ เมื่อ n คือ เวกเตอร์ของตำแหน่ง ค่า elastic moduli C_{ijkl} แทนด้วย C_{11}, C_{12} และ C_{44}

Eight-band strain-dependent k.p method

อิทธิพลของความเครียดต่อโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงาน การศึกษาความเครียดสามารถเปลี่ยนแปลงแบบพลังงานภายในโครงสร้างความตั้มดอทสามารถทำได้โดยวิธี eight-band strain-dependent k.p Hamiltonian, $H_k + H_s$, เมื่อ H_k is the kinetic Hamiltonian และ H_s is the strained Hamiltonian. Kinetic Hamiltonian แทนด้วย:

$$\begin{bmatrix} A & 0 & V^* & 0 & \sqrt{3}V & -\sqrt{2}U & -U & \sqrt{2}V^* \\ 0 & A & -\sqrt{2}U & -\sqrt{3}V^* & 0 & -V & \sqrt{2}V & U \\ V & -\sqrt{2}U & -P+Q & -S^* & R & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}S & -\sqrt{2}Q \\ 0 & -\sqrt{3}V & -S & -P+Q & 0 & R & -\sqrt{2}R & \frac{1}{\sqrt{2}}S \\ \sqrt{3}V^* & 0 & R^* & 0 & -P+Q & S^* & \frac{1}{\sqrt{2}}S^* & \sqrt{2}R^* \\ -\sqrt{2}U & -V^* & 0 & R^* & S & -P+Q & \sqrt{2}Q & \sqrt{\frac{3}{2}}S^* \\ -U & \sqrt{2}V^* & \sqrt{\frac{3}{2}}S^* & -\sqrt{2}R^* & \frac{1}{\sqrt{2}}S & \sqrt{2}Q & -P+\Delta & 0 \\ \sqrt{2}V & U & -\sqrt{2}Q & \frac{1}{\sqrt{2}}S^* & \sqrt{2}R & \sqrt{\frac{3}{2}}S & 0 & -P+\Delta \end{bmatrix}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
A &= E_c - \frac{\hbar^2}{2m_0} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\
B &= E_c - \gamma_1 \frac{\hbar^2}{2m_0} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\
Q &= -\gamma_2 \frac{\hbar^2}{2m_0} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\
R &= \sqrt{3} \frac{\hbar^2}{2m_0} [\gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) - 2i\gamma_3 k_x k_y] \\
S &= -\sqrt{3} \gamma_3 \frac{\hbar^2}{2m_0} k_z (k_x - ik_y) \\
U &= \frac{-i}{\sqrt{3}} P_0 k_z \\
V &= \frac{-i}{\sqrt{6}} P_0 (k_x - ik_y)
\end{aligned}$$

P_0 แทนค่าการคำนวณที่ยังไม่ได้พิจารณาความเครียดตามคำอธิบาย และ Δ ค่าแยกตัวอันเนื่องมาจากการ spin-orbit $\gamma_{i=1,2,3}$ คือค่า Luttinger ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนซึ่งอยู่ในรูปของค่า Luttinger แบบธรรมชาติ $\gamma_{i=1,2,3}^L$:

$$\begin{aligned}
\gamma_1 &= \gamma_1^L - \frac{E_p}{3E_g + \Delta} \\
\gamma_2 &= \gamma_2^L - \frac{1}{2} \frac{E_p}{3E_g + \Delta} \\
\gamma_3 &= \gamma_3^L - \frac{1}{2} \frac{E_p}{3E_g + \Delta}
\end{aligned}$$

$E_g = E_c - E_v$ คือค่าซึ่งว่างของแบบพลังงาน และ $E_p = 2m_0 P_0^2 / \hbar^2$ Strained Hamiltonian แทนด้วย:

$$\left[\begin{array}{cccccccc}
a_c e & 0 & -v^* & 0 & -\sqrt{3}v & \sqrt{2}u & u & -\sqrt{2}v^* \\
0 & a_c e & \sqrt{2}u & \sqrt{3}v^* & 0 & v & -\sqrt{2}v & -u \\
-v & \sqrt{2}u & -p+q & -s^* & r & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}s & -\sqrt{2}q \\
0 & \sqrt{3}v & -s & -p+q & 0 & r & -\sqrt{2}r & \frac{1}{\sqrt{2}}s \\
-\sqrt{3}v^* & 0 & r^* & 0 & -p+q & s^* & \frac{1}{\sqrt{2}}s^* & \sqrt{2}r^* \\
\sqrt{2}u & v^* & 0 & r^* & s & -p+q & \sqrt{2}q & \sqrt{\frac{3}{2}}s^* \\
u & -\sqrt{2}v^* & \sqrt{\frac{3}{2}}s^* & -\sqrt{2}r^* & \frac{1}{\sqrt{2}}s & \sqrt{2}q & -p & 0 \\
-\sqrt{2}v & u & -\sqrt{2}q & \frac{1}{\sqrt{2}}s^* & \sqrt{2}r & \sqrt{\frac{3}{2}}s & 0 & -p
\end{array} \right]$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
e &= e_{xx} + e_{yy} + e_{zz} \\
p &= a_v(e_{xx} + e_{yy} + e_{zz}) \\
q &= b[e_{zz} - \frac{1}{2}(e_{xx} + e_{yy})] \\
r &= \frac{\sqrt{3}}{2}b(e_{xx-e_{yy}}) - ide_{xy} \\
s &= -d(e_{xz} - ie_{yz}) \\
u &= \frac{-i}{\sqrt{3}}P_0 \sum_j e_{zj} k_j \\
v &= \frac{-i}{\sqrt{6}}P_0 \sum_j (e_{xj} - ie_{yj}) k_j
\end{aligned}$$

e_{ij} แทนค่าความเครียด, b และ d แทนค่า shear deformation potentials. a_v คือ hydrostatic valence band deformation potential และ a_c คือ conduction-band deformation potential.

Piezoelectricity

ความเครียดที่เกิดขึ้นในความตั้มดอทก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมมาร์ตรของโครงสร้างทางพลีก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดปรากฏการณ์ โพลาไรเซชัน นิยามด้วย Piezoelectricity

พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการประกาย Piezoelectricity สามารถหาจากสมการ Poisson แทนด้วย

$$\nabla^2 V_{pz} = \frac{\rho}{\epsilon(r)}$$

เมื่อ V_{pz} คือ พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการประกาย Piezoelectricity ρ แทนค่า piezoelectric charge นิยามว่า:

$\rho = -\nabla \cdot P$ และ P คือ ค่า โพลาไรเซชัน แทนด้วย:

$$P = 2e_{14} \begin{vmatrix} e_{yz} \\ e_{xz} \\ e_{xy} \end{vmatrix}$$

โดยที่ e_{yz} , e_{xz} และ e_{xy} คือ ค่าความเครียดเฉือน และ e_{14} คือ ค่าคงที่ Piezoelectricity ขอแต่ละสาร $\epsilon(r)$ คือ ค่าคงที่ dielectric ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง r พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการประกาย Piezoelectricity สามารถหาได้จากการแก้สมการ Poisson โดยวิธี Finite difference หลังจากได้พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการประกาย Piezoelectricity Hamiltonian ของความตั้มดอทจะเท่ากับ

$$H = H_{k,p} + V_{pz} I$$

เมื่อ $H_{k,p}$ is the Hamiltonian จากวิธีเดคอฟฟิซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป และ I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์

วิธีเคดอฟฟิ (k.p method)

เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของความตั้มดอทเราต้องเข้าใจโครงสร้างของวัสดุ มีการคำนวณตามทฤษฎีของโครงสร้าง helytic เช่น Tight-binding Pseudo-potential k.p เป็นต้น ซึ่งเทคนิคแต่ละอย่างมีแนวทางในการคำนวณคุณสมบัติของเชมิคอลดักเตอร์ที่แตกต่างกัน แต่เริ่มต้นจากสมการพื้นฐานสมการ Schrodinger ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้วิธี k.p ในการศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคความตั้มดอท

Two-band model

วิธีนี้จะใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานของสถานะอิเล็กตรอน พิงก์ชันคลื่นของสถานะอิเล็กตรอน อยู่ในรูปของการรวมกันเชิงเส้นของ Conduction band ดังสมการ

$$\psi_{i_\epsilon}^e(\vec{r}) = \sum_{s_z=\pm 1/2} g_{i_\epsilon, s_z}^e(\vec{r}) u_{s_z}(\vec{r})$$

เมื่อ $s = 1/2, s_z = \pm 1/2$

$$|u_{1/2;+1/2}\rangle = s \uparrow$$

$$|u_{1/2;-1/2}\rangle = s \downarrow$$

Four-band model

วิธีนี้จะใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานของสถานะเวลี่นอิเล็กตรอน พิงก์ชันคลื่นของสถานะเวลี่นอิเล็กตรอน อยู่ในรูปของการรวมกันเชิงเส้นของ Valence band ดังสมการ

$$\psi_{i_\nu}^v(\vec{r}) = \sum_{j_z=\pm 1/2, \pm 3/2} g_{i_\nu, j_z}^v(\vec{r}) u_{j_z}(\vec{r})$$

เมื่อ

$$|3/2;+3/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} [|X\uparrow\rangle + i |Y\uparrow\rangle]$$

$$|3/2;+1/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{6}} [|X\downarrow\rangle + i |Y\downarrow\rangle - 2 |Z\uparrow\rangle]$$

$$|3/2;-1/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{6}} [|X\uparrow\rangle - i |Y\uparrow\rangle + 2 |Z\downarrow\rangle]$$

$$|3/2;-3/2\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}} [|X\downarrow\rangle + i |Y\downarrow\rangle]$$

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

1. สถานที่ทำการทดลองและเก็บข้อมูลอยู่ที่ กลุ่มวิจัย Quantum Dot ที่อาคารภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ศึกษาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งค่าทั้งในเชิงทฤษฎีและการทดลอง
3. ทำการวิจัยตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยใช้คอมพิวเตอร์ทำงานวิจัยและเปรียบเทียบผลการคำนวณกับการทดลองดังแผนการดำเนินงานในข้อ 3.1-3.4
4. รายงานผลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

กิจกรรม	ช่วงเวลา (เดือน)												ผลงานที่จะได้จาก กิจกรรม *
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. การเตรียมงานวิจัย/ทบทวน ศึกษาเอกสาร													
2. กำหนดแผนการ/วิธีการ ดำเนินงานวิจัย													
3. ดำเนินงานวิจัย/เก็บข้อมูล													
3.1 ศึกษาการกระจายตัวของ ความเครียดภายในและรอบๆ ความตั้งค่า													สมบัติการกระจายตัว ของความเครียดเมื่อ ความตั้งค่าที่มีรูปร่าง ต่างๆ
3.2 ศึกษาปรากฏการณ์เพียงโซ่อิเล็ก ทรอนิกของความตั้งค่า													เข้าใจคุณสมบัติของ ปรากฏการณ์เพียงโซ่อิเล็ก ทรอนิกที่มีต่อคง วนตั้งค่า
3.3 คำนวณหาระดับพลังงานของ สถานะอิเล็กตรอนและโซลของ ความตั้งค่า													มีความรู้เกี่ยวกับระดับ พลังงานภายใน ความตั้งค่าที่มี ความตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลง ไป
3.4 ศึกษาและคำนวณสเปคตรัม													มีความรู้เกี่ยวกับ

บทที่ 4

ແຄນພັ້ງງານອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມເຄີຍດອງ InAs/GaAs ຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ (Strain-induced band profile of stacked InAs/GaAs Quantum Dots)

ນາກນຳ

งานວິຊຍະແກຣມພັ້ນໃນດ້ານສາຮັກໍ່ດ້ວນຈະພາບານລົດຂາດແລະທຶນທາງກາຣເຄີ່ອນທີ່ຂອງອນຸກາຈາກ ອນຸກາ ອີສະຣ (3D bulk material), ຄວອນຕົ້ມເວລີ໌ (2D Quantum Well), ຄວອນຕົ້ມໄວ້ (1D Quantum Wire)ແລະສຸດທ້າຍຄວອນຕົ້ມຄອທ (0D Quantum Dot) ເຮັງຄາມດຳດັບກາຣເຄີ່ອນທີ່ຂອງອນຸກາ ດັ່ງນັ້ນກາຣທີ່ອນຸກາຄູກກັງທັງ 3 ມີສົມບັດທີ່ພົບຈະແຕກຕ່າງກັນ ອໜ່າງນາກ ເຊັ່ນ ສົມບັດກາຣເປັນອະຕອນຂອງສາຮ (atomic-like orbital) ພັ້ງງານຢືນເຫັນວ່າອັກຊີຕອນເພີ່ມເຂົ້າ (Exciton binding energies) ແລະກາຣເຮືອງແສງ (Luminescence) ເປັນດັ່ນ ຄວອນຕົ້ມຄອທສາມາດປະບຸກຕີໃນກາຣປະດິຍູ້ ທຣານຊີສເທອຣ (Transistor) ເຊລີ໌ແສງອາທິດຍ໌ (Solar cell) ອລດອເຮືອງແສງ (LED) ແລະ ເລເຊອຣໄໂຄໂອດ (Laser diode) ເປັນດັ່ນ ຕົວໜ່າຍຸ້ນເອງ ສົມບັດທາງໂຄຮງສ້າງແລະແສງຂອງຄວອນຕົ້ມຄອທຈຶ່ງໄດ້ຮັບກາຣສຶກຍາກັນອ່າຍ່າງກວ້າງຂວາງ [1] ຕ້ອວຍ່າງເຊັ່ນ ກາຣສຶກຍາກາຣ ປຸດປັລ່ອພັ້ງງານແລະກະບວນກາຣຜ່ອນຄະບາຍຂອງພາຫະ (carrier relaxation process) ຂອງຄວອນຕົ້ມຄອທ 2-10 ຕັ້ງທີ່ເຮັງທັນ ກັນທ່າງກັນ 2-3 ນາໂນມີຕຣ [2] ປັບປຸງບັນໄດ້ມີກາຣສຶກຍາຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນໃນແນວດີ (Vertically stacked Quantum dots) ໃນກາຣປະບຸກຕີໃນດ້ານຄວອນຕົ້ມຄອທເລເຊອຣ (Quantum dots laser) ແລະຄວອນຕົ້ມຄອມພິວເຕອຣ (Quantum computer) [3] Kita ແລະຜູ້ຮ່ວມວິຊຍ [4, 5] ທຳກາຣທົດຄອງເພື່ອຄວບຄຸມປາກູກາຣົນໂພລາໄຣເຊັ້ນ (Polarization) ທີ່ເກີດເຂົ້າໃນ InAs/GaAs ຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ ໂດຍທີ່ໄມ້ມີຮະບະທ່າງຮ່າງຮ່າງຄວອນຕົ້ມຄອທ Saito ແລະຜູ້ຮ່ວມວິຊຍ [3, 5] ຄຳນວນຫາຄ່າຄວາມເຄີຍດແລະໂຄຮງສ້າງທາງອີເລີກທຣອນິກຂອງ InAs/GaAs ຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ ໂດຍທີ່ຮະບະທ່າງຮ່າງຮ່າງຄວອນຕົ້ມຄອທຢູ່ໃນໜ່ວຍ 0-6 ນາໂນມີຕຣໂດຍໃຊ້ວິຊ elastic continuum theory ແລະວິຊ eight-band k.p ນອກຈາກນີ້ Saito ແລະຜູ້ຮ່ວມວິຊຍັ້ງສຶກຍາປາກູກາຣົນໂພລາໄຣເຊັ້ນຂອງແສງ (Optical polarization) ໃນ InAs/GaAs ຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ ໂດຍທີ່ໄມ້ມີຮະບະທ່າງຮ່າງຮ່າງຄວອນຕົ້ມຄອທ Janusz Andrzejewski ແລະຜູ້ຮ່ວມວິຊຍ [7] ເສັນອຸດກາຣຄຳນວນໂດຍວິຊ eight-band k.p ຂອງສົມບັດທາງໂຄຮງສ້າງອີເລີກທຣອນິກສະແພໂພລາໄຣເຊັ້ນຂອງ $In_xGa_{1-x}As / GaAs$ ຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ ໂດຍທີ່ໄມ້ມີຮະບະທ່າງຮ່າງຮ່າງຄວອນຕົ້ມຄອທ ອ່າຍ່າງໄກ້ຕາມຈານວິຊັ້ນດັ່ງກ່າວ ບັນໄມ້ໄດ້ສຶກຍາແນວໂນມຂອງຮະບະທ່າງຮ່າງຮ່າງຄວອນຕົ້ມຄອທຕ່ອງຄວາມເຄີຍດ (Strain) ແລະແຄນພັ້ງງານຂອງຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ (Band profile) ຜົ່ງເຂົ້າມຸລດັ່ງກ່າວ ເປັນພື້ນຖານໃນກາຣຄວບຄຸມປາກູກາຣົນໂພລາໄຣເຊັ້ນຂອງແສງຊື່ງເປັນປະໂຍ່ນໃນກາຣປະບຸກຕີທາງແສງ

ໃນບັນນີ້ ຈະນຳເສັນອຸດກາຣຄຳນວນກາຣຮະບະທ່າງຄວອນຕົ້ມຄອທໃຫ້ພົບຖ້າຍື້ທີ່ກ່າວໜ້າງດັ່ນ ຜູ້ຮ່ວມວິຊຍ ເພື່ອຄວບຄຸມປາກູກາຣົນໂພລາໄຣເຊັ້ນໃນ InAs/GaAs ຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ ໂດຍຮະບະທ່າງຮ່າງຮ່າງຫຼັ້ນອີຍໃນໜ່ວຍ 0-6 ນາໂນມີຕຣ ນອກຈາກນີ້ບັນຍັດສຶກຍາອີທີພລຂອງຄວາມເຄີຍດທີ່ເກີດເຂົ້າໃນ InAs/GaAs ຄວອນຕົ້ມຄອທກັບແຄນພັ້ງງານຂອງຄວອນຕົ້ມຄອທທີ່ເຮັງທັນກັນ ອີກດ້ວຍ

ກຸ່ມມື

ກາຣກະຈາຍຕ້ວຂອງຄວາມເຄີຍດ (Strain distribution)

ພລຽມຂອງພັ້ງງານອັນເນື່ອງມາຈາກກາຣກະຈາຍຕ້ວຂອງຄວາມເຄີຍດເທົ່າກັນ [3, 8, 9]

$$U_{CE} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} C_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl}$$

ພິຈາລະນາອຸນຸກາຈາກຄວອນຕົ້ມຄອທ ອ່ານ U_{CE} ສາມາດຮາໄດ້ຈາກກາຣກະຈາຍຕ້ວຂອງຄວາມເຄີຍດເທົ່າກັນ U_{CE} ມີຄ່ານ້ອຍທີ່ສຸດໂດຍປະບຸກຕີ Finite difference ອ່ານ ε_{ij} ຕາມແນວ i ແລະ j ສາມາດຮາໄດ້ຈາກ $\varepsilon_{ij} = \left(\frac{du_i}{dx_j} + \frac{du_j}{dx_i} \right) / 2$ ເມື່ອ n ຄືອ

เวกเตอร์ของคำแนะนำ ค่า elastic moduli C_{ijkl} แทนด้วย C_{11}, C_{12} และ C_{44} โดยในตารางที่ 1 แสดงค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณความเครียด [10]

ตารางที่ 1. ค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณความเครียด

	C_{11} (GPa)	C_{12} (GPa)	C_{44} (GPa)	e_{14} (C.m $^{-2}$)	ε
InAs	83.3	45.3	39.6	-0.115	14.6
GaAs	118.8	53.8	59.4	-0.230	13.18

Eight-band strain-dependent k.p method

อิทธิพลของความเครียดต่อโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานการศึกษาความเครียดสามารถเปลี่ยนแปลงแบบพลังงานภายใต้โครงสร้างความตันของสารทำได้โดยวิธี eight-band strain-dependent k.p Hamiltonian, $H_k + H_s$, เมื่อ H_k is the kinetic Hamiltonian และ H_s is the strained Hamiltonian ตารางที่ 2 แสดงค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณ Eight-band strain-dependent k.p method [11]

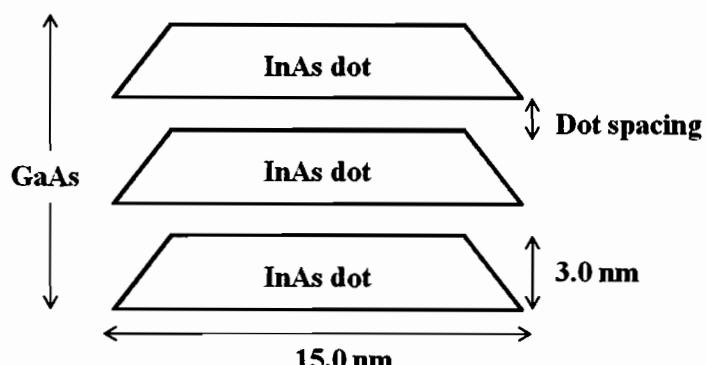
ตารางที่ 2. ค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณ Eight-band strain-dependent k.p method

Parameters	InAs	GaAs
γ_1^L	19.67	6.85
γ_2^L	8.37	2.1
γ_3^L	9.29	2.9
E_g (eV)	0.418	1.519
Δ (eV)	0.38	0.33
E_p (eV)	22.2	25.7
a_c (eV)	-6.66	-8.6
a_v (eV)	0.66	-9.3
b (eV)	-1.8	0.7

d(eV)	-3.6	-2.0
-------	------	------

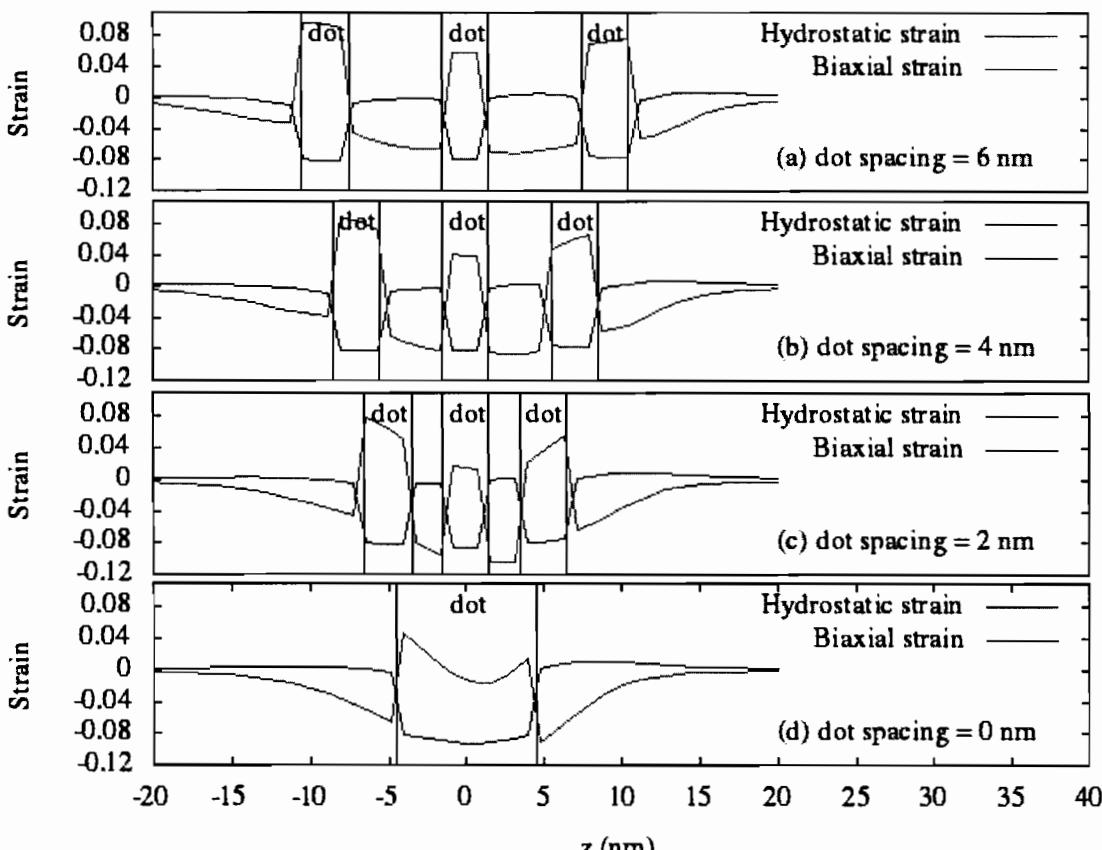
ผลการคำนวณ

ในงานวิจัยนี้ ความตั้มดอทที่เรียงทับกันถูกจำลองขึ้นโดยประกอบด้วย InAs ความตั้มดอทจำนวน 3 ตัวที่วางตัวในแนวตั้งบรรจุภายในสาร GaAs ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง ทิศทางการเรียงตัวของความตั้มดอทจะอยู่ในแนวแกน z ความตั้มดอทแต่ละตัวจะมีขนาดเท่ากันและมีรูปร่างเป็นพิรัมิดเนื่องจากรูปร่างดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลอง ความตั้มดอทนี้ความสูงเท่ากับ 3.0 นาโนเมตร และฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 15×15 นาโนเมตร² ระยะห่างระหว่าง ความตั้มดอทอยู่ในช่วง 0.0- 6.0 นาโนเมตร รูปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของความตั้มดอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว ความเครียดที่เกิดขึ้นในความตั้มดอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว ถูกคำนวณโดยวิธี continuum elasticity theory ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้ในการคำนวณความเครียดในความตั้มดอท 1 ตัว [12, 13].



รูปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของความตั้มดอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว

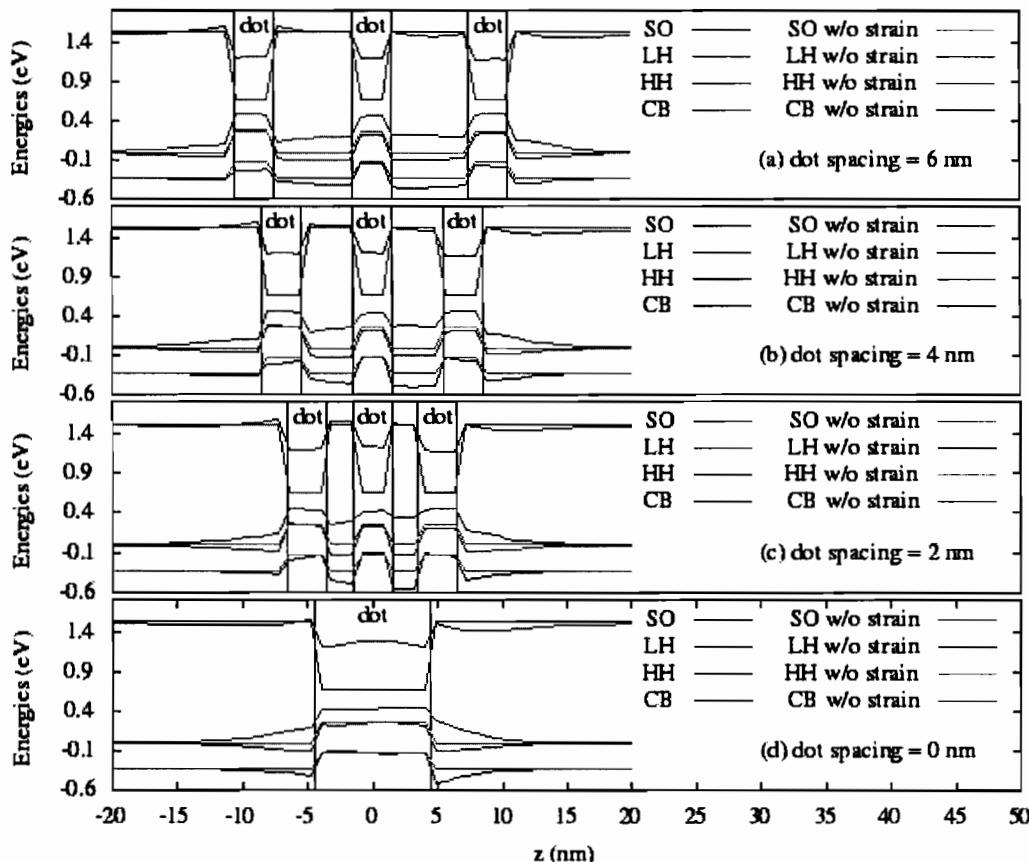
ในการศึกษาแบบพลังงานของความตั้มดอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว ความเครียดแบบ hydrostatic และ biaxial ได้รับ การศึกษา โดยนิยาม ความเครียดแบบ hydrostatic $\epsilon_H = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}$ และ ความเครียดแบบ biaxial $\epsilon_B = \epsilon_{zz} - (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})/2$ ความเครียดแบบ hydrostatic จะยกแบบพลังงานคงตั้งขึ้นและเวลน์ ในขณะที่ ความเครียดแบบ biaxial จะทำให้แนบระดับพลังงานเวลน์ที่เคยเท่ากัน มีค่าต่างกัน เมื่อพิจารณาความเครียด ในบทนี้ผู้อ่านจะศึกษาเพิ่ม ของระยะห่างระหว่างความตั้มดอทต่อความเครียดแบบ hydrostatic และ ความเครียดแบบ biaxial รูปที่ 2 แสดง ความเครียดแบบ hydrostatic และ ความเครียดแบบ biaxial ตามแนวแกน z เมื่อระยะห่างระหว่างความตั้มดอทมีค่า เปเลี่ยนไป จากกราฟพบว่า ในบริเวณ GaAs ความเครียดแบบ hydrostatic จะมีค่าเท่ากับศูนย์ ในขณะที่บริเวณ ความตั้มดอท ความเครียดแบบ hydrostatic จะมีค่าเท่ากับ -0.08 ผลการคำนวณบอกว่ามีการบีบเกิดขึ้นภายในบริเวณ ความตั้มดอท ($\epsilon_H < 0$) (Compressive) เนื่องจากสาร GaAs ที่มีค่าความยาวของโครงสร้างสั้นกว่าความยาวของโครงสร้าง ของสาร InAs จะบีบความตั้มดอท ณ ระยะห่างระหว่างความตั้มดอทเท่ากับ 0.0 นาโนเมตร ความเครียดแบบ biaxial มีค่า น้อยและมีค่าลบในจุดกึ่งกลางของความตั้มดอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว เมื่อระยะห่างระหว่างความตั้มดอทเพิ่มขึ้น ความเครียด แบบ biaxial ในบริเวณความตั้มดอทจะมีขนาดเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากความยาวของโครงสร้างของสาร InAs ในแนวแกน z มีค่าแตกต่างกับความยาวของโครงสร้างของสาร GaAs ในแนวแกน z ส่วนในบริเวณรอบนอกความตั้มดอท ความเครียด แบบ biaxial จะมีค่าเป็นลบ เมื่อระยะห่างระหว่างความตั้มดอทเพิ่มขึ้น ความเครียดแบบ biaxial จะค่อยๆเพิ่มขึ้น



รูปที่ 2 การกระจายตัวของความเครียดใน InAs/GaAs ความตั้มคอที่เรียงทับกัน 3 ตัว เมื่อระยะห่างระหว่าง ความตั้มคอท่ากัน (a) 6 นาโนเมตร, (b) 4 นาโนเมตร, (c) 2 นาโนเมตร and (d) 0 นาโนเมตร

หลังจากศึกษาพฤติกรรมของความเครียด ต่อมานำไปวิจัยได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแถบพลังงาน (Strain-modifying band profile) ของ InAs/GaAs ความตั้มคอที่เรียงทับกัน 3 ตัว โดยใช้วิธี eight-band strain-dependent k.p ผู้วิจัย ศึกษาอิทธิพลของระยะห่างระหว่างความตั้มคอท่อແບบพลังงานของความตั้มคอที่เรียงทับกัน 3 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ແບบ conduction, heavy-hole, light-hole และ spin-orbit แสดงในรูปที่ 3 ในแบบจำลองนี้ ค่าผลต่างระหว่างແບบพลังงาน เวลเนซ (valence band offset) ของ InAs และ GaAs อยู่ต่ำกว่า $+0.25$ eV [9]. นอกจากนี้ ผู้วิจัยพิจารณาอิทธิพลของ ความเครียดที่มีผลต่อແບบพลังงาน เช่น กัน ผลการคำนวณพบว่า ความเครียดสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและระดับของ ແບบพลังงานของความตั้มคอที่เรียงทับกัน 3 ตัว ความเครียดแบบ biaxial จะส่งผลให้ระดับพลังงาน heavy hole และ light hole แตกต่างกันเปรียบเทียบกับผลการคำนวณที่ไม่ได้พิจารณาความเครียดแบบ biaxial ใน strained Hamiltonian (H_s) ในແບบพลังงาน conduction (CB) ความเครียดจะส่งผลให้ແບบพลังงานในบริเวณความตั้มคอทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ บริเวณรอบๆ ความตั้มคอทแทนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากอิทธิพลของความเครียดแบบ hydrostatic (ε_H) ใน ແບบพลังงาน heavy hole (HH) ความเครียดจะส่งผลทำให้ແບบพลังงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นในบริเวณความตั้มคอท รอยต่อและ ระหว่างความตั้มคอท ขณะที่ ແບบพลังงาน heavy hole ในบริเวณที่ไม่ได้พิจารณาความตั้มคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ในແບบพลังงาน light-hole (LH) และ spin-orbit (SO) ความเครียดจะส่งผลทำให้ແບบพลังงานดังกล่าวลดลง ในบริเวณระหว่างความตั้มคอทและรอยต่อ ในขณะที่บริเวณความตั้มคอทและบริเวณรอบๆ ที่อยู่ห่างไกลจาก ความตั้มคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นพิจารณาระยะห่างระหว่างความตั้มคอท พบว่า เมื่อไม่ได้ พิจารณาความเครียดในการคำนวณ ແບบพลังงานของความตั้มคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพิจารณา

ความเครียดในการคำนวณจะได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานขึ้นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานขึ้นเนื่องมาจากความเครียดของแบบพลังงานค่อนดักชันและเวลน์ ในบริเวณความตันคอทไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่บริเวณระยะห่างระหว่างความตันคอทเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อระยะห่างระหว่างความตันคอทเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานขึ้นเนื่องมาจากความเครียดในบริเวณระยะห่างระหว่างความตันคอทจะเข้าใกล้สุดแบบพลังงานที่ไม่ได้พิจารณาความเครียดในการคำนวณ



รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานขึ้นเนื่องมาจากความเครียดในความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัวในแนวแกน z เมื่อระยะห่างระหว่างความตันคอทเท่ากับ (a) 6 นาโนเมตร, (b) 4 นาโนเมตร, (c) 2 นาโนเมตร and (d) 0 นาโนเมตร

สรุปผลการคำนวณ

ผู้วิจัยได้อธิบายการกระจายตัวของความเครียดในความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว โดยระยะห่างระหว่างความตันคอทอยู่ในช่วง 0-6 นาโนเมตร ในขั้นตอนแรก ผู้วิจัยคำนวณการกระจายตัวของความเครียดโดยวิธี elastic continuum theory โดยประยุกต์วิธี Finite difference ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานขึ้นเนื่องมาจากความเครียดสามารถหาได้จากวิธี eight-band strain-dependent k.p จากผลการคำนวณพบว่ามีการบีบตัวภายในบริเวณความตันคอท ($\varepsilon_h < 0$) เมื่อระยะห่างระหว่างความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัวเพิ่มขึ้น ความเครียดแบบ biaxial ทึ้งในบริเวณความตันคอทและบริเวณรอบๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการคำนวณพบว่าความเครียดแบบ hydrostatic และความเครียดแบบ biaxial สามารถใช้ในการพิจารณาแบบของแบบพลังงาน ความเครียดแบบ hydrostatic จะกระดับพลังงานค่อนดักชันและเวลน์ในขณะที่ ความเครียดแบบ biaxial จะทำให้แบบพลังงานเวลน์ที่เดียวกัน มีค่าต่างกัน เมื่อพิจารณาความเครียด สุดท้าย ความเครียดและระยะห่างระหว่างความตันคอทส่งผลกระทบอันสำคัญต่อรูปร่างและระดับของแบบพลังงานในความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว

บรรณานุกรม

- [1] M Grundmann. Nano-Optoelectronics: Concepts, Physics, and Devices. Springer-Verlag, New York, 2002, p. 167-199.
- [2] T Nakaoka, T Tatebayashi, and Y Arakawa. Spectroscopy on single columns of vertically aligned InAs quantum dots. *Physica E*. 2004; 21, 409-413.
- [3] T Saito, T Nakaoka, T Kakitsuka, Y Yoshikuni and Y Arakawa. Strain distribution and electronic states in stacked InAs/GaAs quantum dots with dot spacing 0-6 nm. *Physica E*. 2005; 26, 217-221.
- [4] T Kita, O Wada, H Ebe, Y Nakata and M Sugawara. Polarization-Independent Photoluminescence from Columnar InAs/GaAs Self-Assembled Quantum Dots. *Jpn. J. Appl. Phys.* 2002; 41, L1143-L1145.
- [5] T Kita, P Jayavel, O Wada, H Ebe, Y Nakata and M Sugawara. Polarization controlled edge emission from columnar InAs/GaAs self-assembled quantum dots. *Physica Status Solidi (C)*. 2003; 0, 1137-1140.
- [6] T Saito, H Ebe, Y Arakawa, T Kakitsuka and M Sugawara. Optical polarization in columnar InAs/GaAs quantum dots: 8-band $k \cdot p$ calculations. *Phys. Rev. B*. 2008; 77, 195318-195328.
- [7] Janusz Andrzejewski, Grzegorz Sek, Eoin O'Reilly, Andrea Fiore, and Jan Misiewicz. Eight-band $k \cdot p$ calculations of the composition contrast effect on the linear polarization properties of columnar quantum dots. *J. Appl. Phys.* 2010; 107, 073509-073520.
- [8] Oliver Stier. Electronic and Optical Properties of Quantum Dots and Wires. Wissenschaft & Technik Verlag, Germany, 2000, p. 35-40.
- [9] C Pryor, J Kim, LW Wang, AJ Williamson and A Zunger. Comparison of two methods for describing the strain profiles in quantum dots. *J. Appl. Phys.* 1998; 83, 2548-2554.
- [10] Zhao Wei, Yu Zhong-Yuan and Liu Yu-Min. Piezoelectric effects and electronic structures of InAs/GaAs quantum dots grown along (111) and (011) directions. *Chin. Phys. B*. 2010; 19, 067302-067305.
- [11] Craig Pryor. Eight-band calculations of strained InAs/GaAs quantum dots compared with one-, four-, and six-band approximations. *Phys. Rev. B*. 1998; 57, 7190-7195.
- [12] M Grundmann, O Stier and D Bimberg. InAs/GaAs pyramidal quantum dots: Strain distribution, optical phonons, and electronic structure. *Phys. Rev. B*. 1995; 52, 11969-11981.
- [13] T Nakaoka, T Kakitsuka, T Saito, S Kako, S Ishida, M Nishioka, Y Yoshikuni and Y Arakawa. Strain-induced modifications of the electronic states of InGaAs quantum dots. *J. Appl. Phys.* 2003; 94, 6812-6817.



บทที่ 5

อิทธิพลของการกระจายตัวของความเครียดและ Piezoelectricity ต่อสมบัติทางโครงสร้างของควอนตัมคอท

Effect of the strain distribution and piezoelectricity on Electronic structure of Quantum Dots

บทนำ

ในปัจจุบัน โครงสร้างในระดับนาโน เช่น ควอนตัมเวลล์ (Quantum well) ควอนตัมคอท (Quantum dots) ได้รับความสนใจในการศึกษาทั้งในด้านทฤษฎีและทดลองอย่างแพร่หลาย [1-4]. วัสดุสามารถถูกสร้างจากควอนตัมคอท เช่น ไคลโอดีโอดเรืองแสง (Light-emitting diode) และ เลเซอร์ (Laser) เป็นต้น [5-8] ควอนตัมคอทสามารถสังเคราะห์โดยวิธี Stranski-Krastanov ซึ่งอาศัยความแตกต่างกันของความยาวโครงสร้างทางผลลัพธ์ของสาร (Lattice constant) [9] ปัจจุบันนี้ หลักวิธีการคำนวณในการศึกษาโครงสร้างและสมบัติของควอนตัมคอท เช่น วิธี tight-binding, วิธี pseudopotential, วิธี DFT และวิธีเคดอฟฟี (k.p) เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีเคดอฟฟีในการคำนวณหาระดับพลังงานและฟังก์ชันคลื่นของสถานะอิเล็กตรอน (Electron) และไหด (Hole) เนื่องจากวิธีดังกล่าวสามารถศึกษาควอนตัมคอทในขนาดที่ใหญ่ได้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาอิทธิพลของการกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution) และ Piezoelectricity ต่อสมบัติทางโครงสร้างของควอนตัมคอท (Electronic structure) โดยการคำนวณหาระดับพลังงานเมื่อขนาดของควอนตัมคอทมีเปลี่ยนไป โดยพิจารณและไม่พิจารณาความเครียดและ Piezoelectricity ตุดท้ายผู้วิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันคลื่น (Wave functions) ในกรณีที่พิจารณและไม่พิจารณาความเครียดและ Piezoelectricity เช่นกัน

ทฤษฎี

การกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution)

ผลกระทบของพลังงานอันเนื่องมาจากการกระจายตัวของความเครียดเท่ากับ [3, 8, 9]

$$U_{CE} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} C_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl}$$

พิจารณาอนุภาควอนตัมคอท ค่า U_{CE} สามารถหาได้จากการทำให้ขนาดของ U_{CE} มีค่าน้อยที่สุดโดยประยุกต์วิธี Finite difference ค่าความเครียด ε_{ij} ตามแนว i และ j สามารถหาได้จาก $\varepsilon_{ij} = \left(\frac{du_i}{dx_j} + \frac{du_j}{dx_i} \right) / 2$ เมื่อ u คือ เวกเตอร์ของตำแหน่ง ค่า elastic moduli C_{ijkl} แทนด้วย C_{11}, C_{12} และ C_{44} โดยในตารางที่ 1 แสดงค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณความเครียด [10]

ตารางที่ 1. ค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณความเครียด

	C_{11} (GPa)	C_{12} (GPa)	C_{44} (GPa)	e_{14} (C.m ⁻²)	ε
InAs	83.3	45.3	39.6	-0.115	14.6
GaAs	118.8	53.8	59.4	-0.230	13.18

วิธีเคดอฟฟี (k.p method)

เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของความตันคอทเรต้องเข้าใจโครงสร้างของวัสดุ มีการคำนวณตามทฤษฎีของโครงสร้างหลาบริช เช่น Tight-binding Pseudo-potential k.p เป็นต้น ซึ่งเทคนิคแต่ละอย่างมีแนวทางในการคำนวณคุณสมบัติของเช米ค่อนคักเทอร์ที่แตกต่างกัน แต่เริ่มต้นจากสมการพื้นฐานสมการ Schrodinger ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้วิธี k.p ในการศึกษาสมบัติของอนุภาคความตันคอท

Two-band model

วิธีนี้จะใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานของสถานะอิเล็กตรอน พิจารณาขั้นตอนเดียวกันกับการคำนวณของ Conduction band ดังสมการ

$$\psi_{i_e}^e(\vec{r}) = \sum_{s_z=\pm 1/2} g_{i_e, s_z}^e(\vec{r}) u_{s_z; s_z}(\vec{r})$$

เมื่อ $s = 1/2, s_z = \pm 1/2$

$$|u_{1/2;+1/2}\rangle = s \uparrow$$

$$|u_{1/2;-1/2}\rangle = s \downarrow$$

Four-band model

วิธีนี้จะใช้ในการคำนวณหาระดับพลังงานของสถานะเวเลินอิเล็กตรอน พิจารณาขั้นตอนเดียวกันกับการคำนวณของ Valence band ดังสมการ

$$\psi_{i_v}^v(\vec{r}) = \sum_{j_z=\pm 1/2, \pm 3/2} g_{i_v, j_z}^v(\vec{r}) u_{j_z; j_z}(\vec{r})$$

เมื่อ

$$|3/2;+3/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} [|X\uparrow\rangle + i |Y\uparrow\rangle]$$

$$|3/2;+1/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{6}} [|X\downarrow\rangle + i |Y\downarrow\rangle - 2 |Z\uparrow\rangle]$$

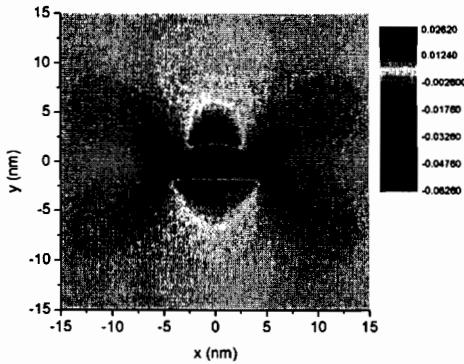
$$|3/2;-1/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{6}} [|X\uparrow\rangle - i |Y\uparrow\rangle + 2 |Z\downarrow\rangle]$$

$$|3/2;-3/2\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}} [|X\downarrow\rangle + i |Y\downarrow\rangle]$$

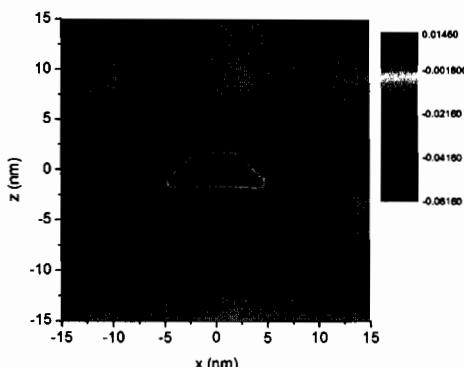
ผลการคำนวณ

การกระจายตัวของความเครียดและ Piezoelectricity

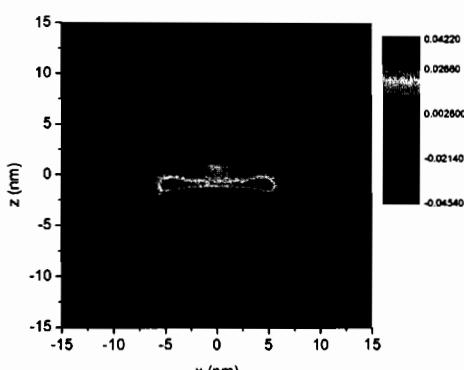
ผู้วิจัยคำนวณการกระจายตัวของความเครียด (Strain distribution) และ Piezoelectricity ของ InAs/GaAs ความตันคอทที่มีรูปร่างแบบพิรามิดที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 10.0×10.0 นาโนเมตร² สูง 3.0 นาโนเมตร เริ่มต้นผู้วิจัยศึกษาการกระจายตัวของความเครียดตามระนาบ xz ของ e_{xx} , e_{yy} และ e_{zz} แสดงในรูป 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ณ ตำแหน่งด้านล่างของความตัน e_{xx} และ e_{yy} เป็นค่าบวก ขณะที่ e_{zz} เป็นค่าลบ ในบริเวณฐานของความตันคอท e_{xx} , e_{yy} และ e_{zz} มีค่าตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา e_{xx} และ e_{yy} มีค่าเป็นลบในบริเวณความตันคอทและมีค่าเป็นบวกในบริเวณยอดของความตันคอท เมื่อ Sar GaAs จะออกแรงบีบ InAs ความตันคอทตามแนวแกน z เมื่อพิจารณาตามทิศทางความสูงของความตันคอทพบว่า ค่าของ e_{zz} จะมีค่าเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบที่ยอดสุดของความตันคอท



รูปที่ 1 กราฟ 2 มิติของ e_{xx}

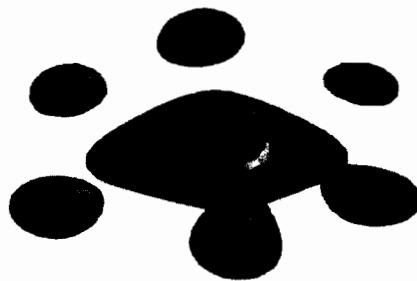


รูปที่ 2 กราฟ 2 มิติของ e_{yy}



รูปที่ 3 กราฟ 2 มิติของ e_{zz}

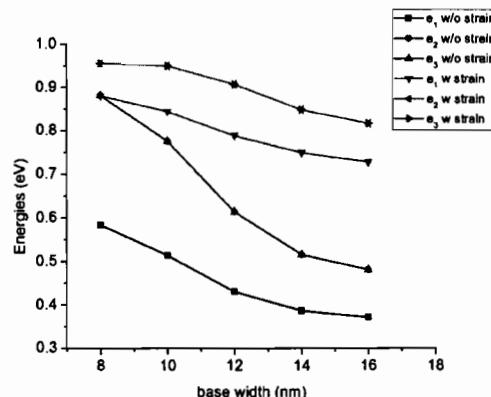
หลังจากนั้นผู้วิจัยคำนวณหาค่าพลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการ发电 Piezoelectricity ของ InAs/GaAs ความอนตัมคอทโดยหาผลเฉลยของสมการ Poisson ใน 3 มิติ รูปที่ 4 แสดงค่าพลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการ发电 Piezoelectricity ใน 3 มิติ ผลการคำนวณอธิบายว่า ค่าพลังงานศักย์จะอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับจุดยอดและฐานของ ความอนตัมคอท นอกจากรูปที่ 4 ยังพบว่า ค่าพลังงานศักย์มีค่าเป็นบวก (สีแดง) ตามแนว [1\bar{1}0] และลบ (สีน้ำเงิน) ตามแนว [110] พลังงานศักย์มีค่า ± 30 meV. การคำนวณยังบ่งบอกว่าเป็นสมมาตรแบบ C_{2v} [3, 4].



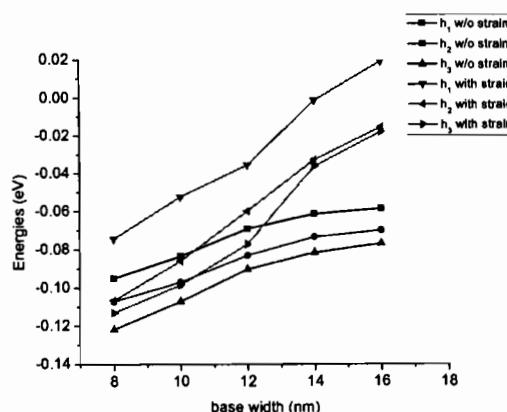
รูปที่ 4 ภาพ 3 มิติของค่าพลังงานศักย์อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Piezoelectricity ของ InAs/GaAs ความตั้มคอก

สมบัติโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์

สมบัติโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของความตั้มคอกที่สังเคราะห์จาก InAs/GaAs โดยวิธีเคลือบทพี รูปร่างของความตั้มคอกคือ พีระมิด ที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด ๖ นาโนเมตร^๒ สูง ๓.๐ นาโนเมตร กราฟที่ ๕, ๖ แสดงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและไฮด์ เมื่อความกว้างของความตั้มคอกมีค่าต่างๆ ตามลำดับ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาอิทธิพลของความเครียดต่อระดับพลังงานของอิเล็กตรอน (Electron) และไฮด์ (Hole) จากการคำนวณพบว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นในความตั้มคอกที่มีผลกระทำต่อระดับพลังงานภายในความตั้มคอก โดยระดับพลังงานของอิเล็กตรอน (Electron) และไฮด์ (Hole) จะเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาความเครียดในการคำนวณ เมื่อเทียบกับการคำนวณระดับพลังงานของสถานะที่ไม่ได้พิจารณาความเครียด นอกจากนี้ เมื่อขนาดของความตั้มคอกเพิ่มขึ้น ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจะลดลง ในขณะที่ระดับพลังงานของไฮด์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ช่องว่างของพลังงานลดลง (Band gap) ดังนั้นค่าช่องว่างของพลังงาน (Band gap) จะถูกปรับได้โดยขนาดของความตั้มคอก

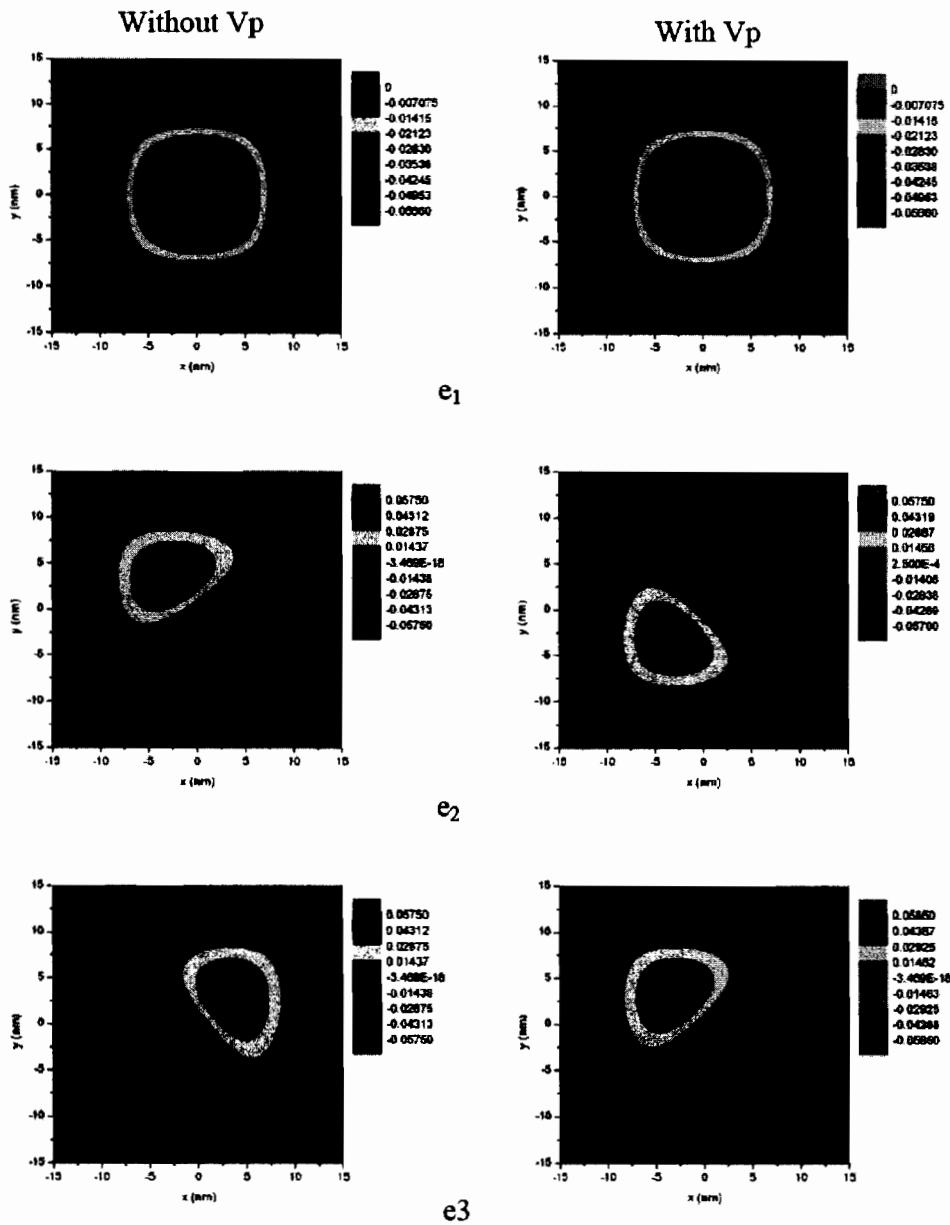


รูปที่ 5 ระดับพลังงานอิเล็กตรอนของ InAs/GaAs ความตั้มคอก ณ ขนาดต่างๆ

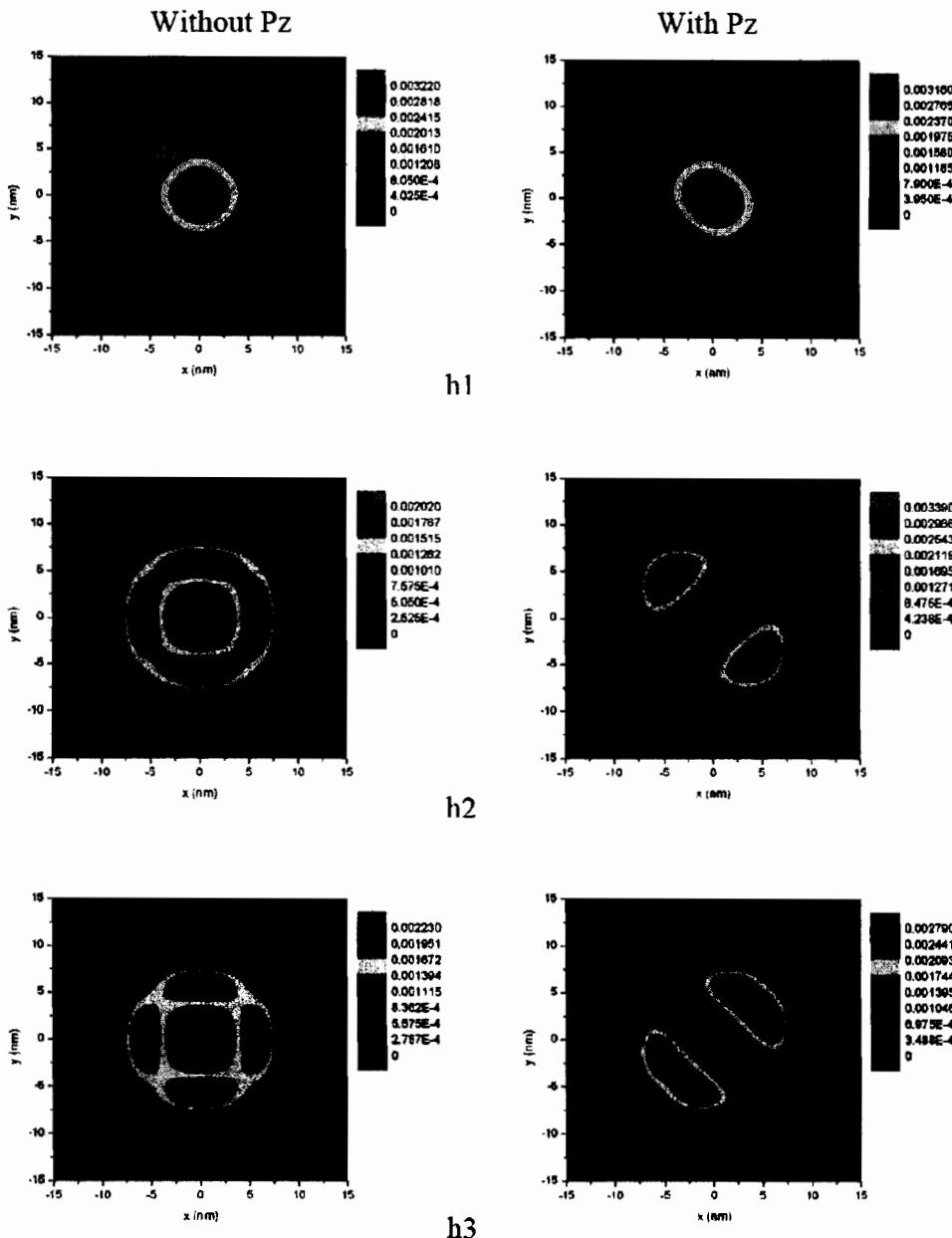


รูปที่ 6 ระดับพลังงาน ไฮด์ของ InAs/GaAs ความตั้มคอก ณ ขนาดต่างๆ

สุดท้ายผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฏการณ์ Piezoelectricity โดยพิจารณาความต้านทานของอิเล็กตรอนและโอลด์ลอกลงน้อยมากเมื่อเทียบกับระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและโอลด์ที่พิจารณาความเครียดในการคำนวณ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลีนของสถานะอิเล็กตรอนและโอลด์ตามแนวแกน x และ y แสดงในรูปภาพ 2 มิติ ที่ 7 และ 8 ตามลำดับ โดยพิจารณา Piezoelectricity ใน การคำนวณและไม่พิจารณา Piezoelectricity ใน การคำนวณ พบร่วมกันว่า พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการณ์ Piezoelectricity ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนตัวของสถานะอิเล็กตรอนที่ 1 (e_1) ซึ่งประกอบด้วยออร์บิ托ล เอส (s orbital) ในส่วนของสถานะอิเล็กตรอนที่ 2 และ 3 (e_2 และ e_3) ซึ่งประกอบด้วยออร์บิ托ลพี (p orbital) Piezoelectricity ทำให้เกิดการกลับทิศทางการวางแผนตัวของฟังก์ชันจาก [1\bar{1}0] เป็น [110] และในทางกลับกันเมื่อเทียบกับการคำนวณที่ไม่ได้พิจารณา Piezoelectricity ในส่วนของสถานะโอลด์ Piezoelectricity ทำให้วางตัวของฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับฟังก์ชันคลีนที่ไม่ได้พิจารณา Piezoelectricity ใน การคำนวณ เนื่องจากสถานะโอลด์สร้างจากการรวมตัวกันของออร์บิ托ลพี (p orbital) การพิจารณา Piezoelectricity สร้างผลให้เกิดสมมตารชนิด C_{2v}



รูปที่ 7 กราฟ 2 มิติของพังก์ชันคุณภาพของสถานะอิเล็กทรอนเมื่อพิจารณาและไม่พิจารณา Piezoelectricity (Pz)



รูปที่ 8 กราฟ 2 มิติของฟังก์ชันคลื่นของสถานะไอลเมื่อพิจารณาและไม่พิจารณา Piezoelectricity (Pz)

สรุปผลการคำนวณ

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของการกระจายตัวของความเครียดและปรากฏการณ์ Piezoelectricity ในเชิงทฤษฎีโดยวิธี continuum elasticity และเคตอนท์ฟี ผลการคำนวณแสดงว่า การกระจายตัวของความเครียดและปรากฏการณ์ Piezoelectricity มีอิทธิพลอย่างมากต่อโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของความต้านทาน โดยความเครียดจะกระตุ้นพลังงานของอิเล็กตรอน และไอลเมื่อเทียบกับการคำนวณที่ไม่ได้พิจารณาความเครียด ในขณะที่พลังงานสักขีอันเนื่องมาจากการณ์ Piezoelectricity ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ 1 (e_1) แต่จะส่งผลให้เกิดการกลับทิศทางการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ 2 และ 3 (e_2 และ e_3) จาก [1-10] เป็น [110] และในทางกลับกัน

บทที่ 6

สรุปผลการคำนวณและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการคำนวณ

ผู้วิจัยได้อธิบายการกระจายตัวของความเครียดในความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว โดยระบุห่างระหว่างความตันคอทอยู่ในช่วง 0-6 นาโนเมตร โดยประยุกต์วิธีทฤษฎีคิดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง (elastic continuum theory) ในคำนวณการกระจายตัวของความเครียด ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบบพลังงานอันเนื่องมาจากความเครียด โดยวิธี eight-band strain-dependent k.p จากผลการคำนวณพบว่ามีการบีบตัวภายในบริเวณความตันคอท ($\varepsilon_h < 0$) เมื่อห่างระหว่างความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัวเพิ่มขึ้น ความเครียดแบบ biaxial ทั้งในบริเวณความตันคอทและบริเวณรอบๆ จึงเพิ่มขึ้น เช่นกัน จากการคำนวณพบว่าความเครียดแบบ hydrostatic และ ความเครียดแบบ biaxial สามารถใช้ในการพิจารณา รูปแบบของแบบพลังงาน ความเครียดแบบ hydrostatic จะกระดับพลังงานคอนดักชันและเวลี่นซ์ในขณะที่ ความเครียดแบบ biaxial จะทำให้กระดับพลังงานเวลี่นซ์ที่เคลียเท่ากัน มีค่าต่างกัน เมื่อพิจารณาความเครียด สุดท้าย ความเครียดและระยะห่างระหว่างความตันคอทส่งผลกระทบอันสำคัญต่อรูปร่างและระดับของแบบพลังงานในความตันคอทที่เรียงทับกัน 3 ตัว

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของการกระจายตัวของความเครียดและปราကุรกรรม Piezoelectricity ในเชิงทฤษฎีโดยวิธี continuum elasticity และเคอคอทที่ ผลการคำนวณแสดงว่า การกระจายตัวของความเครียดและปราคุรกรรม Piezoelectricity มือทิพลอย่างมากต่อโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของความตันคอท โดยความเครียดจะกระดับพลังงานของอิเล็กตรอน และไฮดเมื่อเทียบกับการคำนวณที่ไม่ได้พิจารณาความเครียด ในขณะที่พลังงานศักย์อันเนื่องมาจากการปราคุรกรรม Piezoelectricity ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ 1 (e_1) แต่จะส่งผลให้เกิดการกลับทิศทางการวางแผนตัวของฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ 2 และ 3 (e_2 และ e_3) จาก [110] เป็น [1\bar{1}0] และในทางกลับกัน ในส่วนของสถานะไฮด Piezoelectricity ทำให้วางตัวของฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับฟังก์ชันคลื่นที่ไม่ได้พิจารณา Piezoelectricity ในการคำนวณ

ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอันตรรษาระหว่างอิเล็กตรอนและไฮด ภายในความตันคอ (Electron-hole interaction in Quantum dots) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาเซลล์สุริยะ (Solar cell)
2. งานวิจัยนี้สามารถศึกษาในการประยุกต์ความตันคอทในการศึกษาปราคุรกรรม Polarization ภายในความตันคอ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษา Quantum Computer

បរវាយករណ

1. M.A. Naser, M.J. Deen, D.A. Thompson. (2007). Spectral function and responsivity of resonant tunneling and superlattice quantum dot infrared photodetectors using Green's function. *J. Appl. Phys.*, 102, 083108.
2. V. Ryzhii, V. Mitin, M. Stroscio. (2001). On the detectivity of quantumdot infrared photodetectors. *Appl. Phys. Lett.*, 78, 3523.
3. Oliver Stier. (2000). Electronic and Optical Properties of Quantum Dots and Wires. *Wissenschaft & Technik Verlag*.
4. Worasak Sukkabot. (2010). Electronic Structure of Quantum Dot: Tight-Binding Approach. PhD Thesis, University of Surrey.
5. S. Fafard, K. Hinzer, S. Raymond, M. Dion. (1996). J. McCaffrey, Y. Feng, S. Charbonneau, Red-Emitting Semiconductor Quantum Dot Lasers. *Science*, 274, 1350.
6. Pilkyung Moon, Won Jun, Kwangmin Park, Euijoon Yoon, and JaeDong Lee. (2011). Anomalous strain profiles and electronic structures of a GaAs-capped InAs / In_{0.53}Ga_{0.47}As quantum ring. *J. Appl. Phys.*, 109, 103701.
7. S. I. Rybchenko, G. Yeap, R. Gupta, I. E. Itskevich, and S. K. Haywood. (2007). Importance of aspect ratio over shape in determining the quantization potential of self-assembled zinc-blende III-V quantum dots. *J. Appl. Phys.*, 102, 013706.
8. Beka Bochorishvili. (2011). Electronic states and oscillator strengths for interband transitions of a graded quantum dot quantum well structure. *Physica E.*, 43, 874–876.
9. C. Pryor, J. Kim, L. W. Wang, A. J. Williamson, and A. Zunger. (1998). Comparison of two methods for describing the strain profiles in quantum dots. *J. Appl. Phys.*, 83, 2548.

បររលាយករណ

1. Marius Grundmann Dieter Bimberg and Nikolai N. Ledentsov. Quantum dot heterostructures John Wiley, 1999.
2. Marius Grundmann. The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Devices and Nanophysics. Springer, 2006.
3. Stephen Michael North. Electronic Structure of GaSb/GaAs and Si/Ge Quantum Dots. 2001.
4. P. Harrison. Quantum Wells, Wires and Dots. John Wiley Sons, 2006.
5. Stefan Schulz. Electronic and Optical Properties of Quantum dots: A Tight-Binding Approach. 2007.
6. W.Sukkabot. Electronic Structure of Quantum Dot: Tight-Binding Approach. 2010.
7. Lew Yan Voon, Lok C., Willatzen, Morten. The k p Method: Electronic Properties of Semiconductors, Springer, 2009

ภาคผนวก ก
บทความงานวิจัย

Research Article

Effect of the strain distribution and piezoelectricity on Quantum Dots: k.p method**W.Sukkabot^{1*}**

¹*Department of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, 85 Sathollmark Rd. Warinchamrab, Ubon Ratchathani, Thailand, 34190*

Received <Date>; Accepted <Date>

Abstract

This paper presents the calculations of the electronic structure and strain distribution for self-organized InAs/GaAs quantum dots. The strain calculations are based on the continuum elastic theory. The piezoelectric potential is calculated by solving the 3D Poisson's equation. The electron and hole energy levels of the InAs/GaAs quantum dots are calculated by implementing the k.p method. The calculated results show the importance of strain and piezoelectric effects.

Keywords: Quantum dot, k.p method, strain distribution and piezoelectricity.

1. Introduction

In recent years, the low-dimensional semiconductor nanostructures such as quantum wells and quantum dots (QDs) have attracted much attention in both experimental and theoretical researches [1-4]. Various semiconductor devices built from quantum dots have been studied, e.g., light emitting diodes and laser diodes [5-8]. Quantum dots can be produced by means of the Stranski-Krastanov process which uses the relief of elastic energy when two materials with a

large lattice mismatch form an epitaxial structure [9]. In order to understand the electronic properties of the quantum dots, there are several approaches. In this work, we have calculated the single-particle electron and hole states and wave functions by implementing the k.p method because of the advantage to handle the computations in large sizes of quantum dots.

The aim of this study is to theoretically investigate the effect of strain and piezoelectricity on the electronic structures of self-assembled InAs/GaAs quantum dots. We calculate the energy trends as a function of dot sizes with and without

*Corresponding author.

E-mail address: w.sukkabot@gmail.com

including the strain field and piezoelectricity. Finally, the wave functions of electron and hole states are evaluated with and without the piezoelectricity.

2. Theory

Strain Distribution

The atomic positions inside and around the quantum dot can be described in terms of the supercell of the Face-centered cubic structure. Due to the lattice mismatch between quantum dot and surrounding material, the atomic positions can change and the strain field also takes place in this structure. Continuum elasticity (CE) is determined to study. The total strain energy in the CE model is given by [3, 9]:

$$U_{CE} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} C_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl}$$

For a given structure, U_{CE} is minimized by using finite differences for the strains. The strain and the stress can be expressed as

$$\varepsilon_{ij} = \left(\frac{du_i}{dx_j} + \frac{du_j}{dx_i} \right) / 2,$$

where u is the displacement vector field. The elastic moduli C_{ijkl} are represented by the parameters C_{11} , C_{12} and C_{44} for cubic crystals. Table I shows the material parameters [10] used for the calculation.

Piezoelectricity

The strain in quantum dot causes the atoms in the structure to change the crystal lattice geometry [10-12]. These changes can guide to the polarization in this structure. The piezoelectricity is defined as the creation of electric polarization by the application of stress to a crystal lacking a center of symmetry.

The piezoelectric potential is obtained by solving Poisson's equation.

$$\nabla^2 V_{pz} = \frac{\rho}{\epsilon(r)}$$

Where V_{pz} is the piezoelectric potential. ρ is the piezoelectric charge defined as :

$$\rho = -\nabla \cdot P$$

And P is the polarization given by:

$$P = 2e_{14} \begin{vmatrix} e_{yz} \\ e_{xz} \\ e_{xy} \end{vmatrix}$$

Where e_{yz} , e_{xz} and e_{xy} are the off-diagonal components of the strain tensors and e_{14} is the piezoelectric constant of the considered material. $\epsilon(r)$ is the static dielectric constant of the respective material at the position r . The parameters used to calculate the piezoelectricity are expressed in Table I. The piezoelectric potentials can be obtained by solving the 3D Poisson's equation in the path of the finite difference method. The piezoelectric potential is incorporated to k.p Hamiltonian as a diagonal term [13]:

$$H = H_{k,p} + V_{pz} I$$

Where $H_{k,p}$ is the k.p Hamiltonian and I is the identity matrix.

Electronic structure

In order to study the electronic properties of quantum dots, the band structure of the materials is symmetrically understood. There are several theoretical calculations such as effective mass [14], tight-binding [15, 16], pseudopotential [17], k.p method [3] and density functional theory [18]. Each technique has their own path to theoretically calculate the band properties of semiconductors. However, they start from the fundamental equation, Schrodinger equation. In this work, we have implemented the two-band model and four-band model to investigate the electron and valence states of quantum dots, respectively.

In two-band model, the wave functions of the electron states are a linear combination of the conduction bands given by:

$$\psi_{i,s}^e(\vec{r}) = \sum_{s_z=\pm 1/2} g_{i,s_z}^e(\vec{r}) u_{s,s_z}(\vec{r})$$

Where $s = 1/2$, $s_z = \pm 1/2$

$$|u_{1/2,+1/2}\rangle = s \uparrow$$

$$|u_{1/2,-1/2}\rangle = s \downarrow$$

g_{i,s_z}^e is the coefficient

In four-band model, the wave functions of the valence states are a linear combination of the valence bands defined as:

$$\psi_{i_v}^v(\vec{r}) = \sum_{j_z=\pm 1/2, \pm 3/2} g_{i_v, j_z}^v(\vec{r}) u_{j_z}(\vec{r})$$

Where

$$\text{Heavy hole } |3/2; +3/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} [|X\uparrow\rangle + i |Y\uparrow\rangle]$$

$$\text{Light hole } |3/2; +1/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{6}} [|X\downarrow\rangle + i |Y\downarrow\rangle - 2 |Z\uparrow\rangle]$$

$$\text{Light hole } |3/2; -1/2\rangle = \frac{i}{\sqrt{6}} [|X\uparrow\rangle - i |Y\uparrow\rangle + 2 |Z\downarrow\rangle]$$

$$\text{Heavy hole } |3/2; -3/2\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}} [|X\downarrow\rangle + i |Y\downarrow\rangle]$$

g_{i_v, j_z}^v is the coefficient

3. Results and Discussion

Strain distribution and Piezoelectricity

We have analyzed the strain distribution and the piezoelectricity in pyramidal InAs/GaAs quantum dot. To model the structure, we choose a finite GaAs zinc-blende lattice within a box with the boundary conditions. Within this box, we consider an InAs base width of 10.0 nm and height of 3.0 nm.

To consider strain influence on InAs/GaAs quantum dot, the knowledge of the strain tensors is essential. We have calculated the strain tensors at the middle of the y axis scanning along x and z directions. The contour plots of the strain tensors e_{xx} , e_{yy} and e_{zz} are visualized in Figure 1, 2 and 3, respectively. Below the InAs quantum dot, e_{xx} and e_{yy} are positive, while e_{zz} is negative. In the base region of the quantum dot, the situation is reversed. e_{xx} and e_{yy} are negative in the dot area and becomes positive at the top of quantum dot because GaAs substrate compresses the InAs dot mainly along the z direction. e_{zz} in Figure 3 is positive at the base of quantum dot. With increasing height within the dot, e_{zz} changes its sign and becomes negative at the top of the dot. At the top of dot, the force acting on the dot originates from the GaAs surrounding

material. It causes the e_{zz} become negative and e_{xx} and e_{yy} become positive.

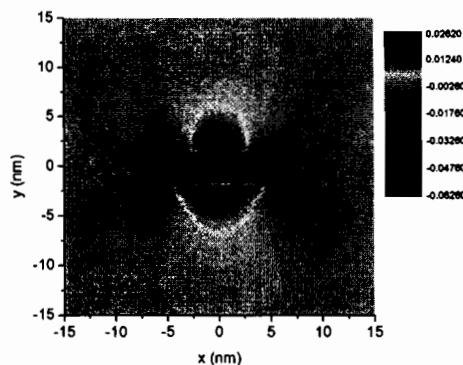


Figure 1. 2D plot of e_{xx} .

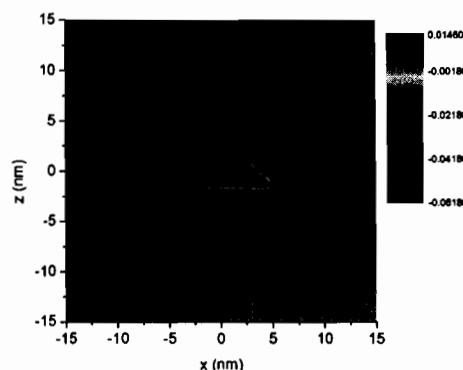


Figure 2. 2D plot of e_{yy} .

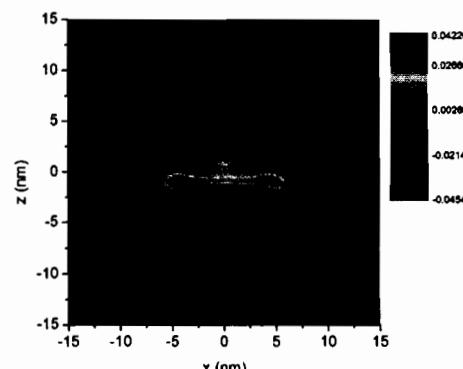


Figure 3. 2D plot of e_{zz} .

Then we have calculated the piezoelectric potential in InAs/GaAs quantum dot by solving the corresponding 3D Poisson's equation. We plot the isosurface of

the piezoelectric potential. It shows that the piezoelectric potential is concentrated in the region close to the top and bottom of the pyramid. It illustrates that the piezoelectric potential is mostly positive (red isosurface) along the $[1\bar{1}0]$ direction and negative (blue isosurface) along the $[110]$ direction. The isosurface potentials are ± 30 meV. This calculation introduces C_{2v} symmetry [3, 4].

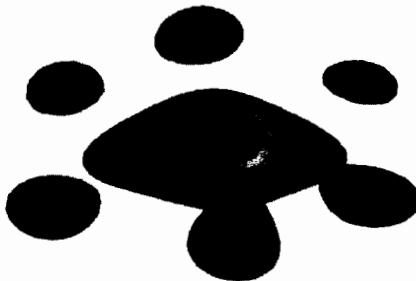


Figure 4. 3D plot of the piezoelectric potential of InAs/GaAs quantum dot.

Electronic structure

The electronic structure of InAs quantum dot in GaAs surrounding material has been studied by means of k.p calculation. The shape of quantum dot in this calculation is truncated pyramid. The base width is b nm and the height of the dot is 3.0 nm. The energy spectra of electron and hole states are plotted as a function of the dot base widths in Figure 5 and 6, respectively. To investigate the influence of the strain field, these calculations are done in the presence and in the absence of strain effects. The numerical results demonstrate that the strain distribution in the quantum dot and surrounding material has a dominant influence on the electronic structure. The energies of electron and hole states taking into account the strain effect are shifted into the high energy side in comparison with ones without considering the strain effect. The graphs also show that the electron energies decrease with increasing the base widths, while the hole energies become rising as a function of the increasing base widths. Therefore, the band gap energies are reduced. The size-dependent property can be used to tune the band gap energies of the quantum dots.

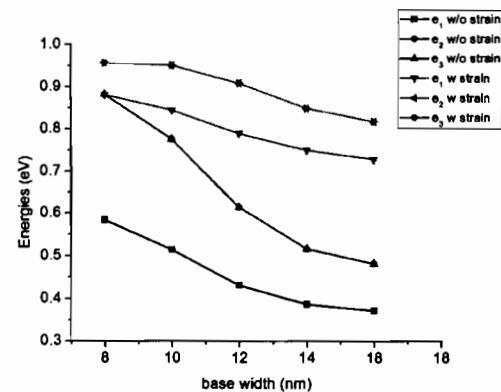


Figure 5. Electron energies of InAs/GaAs quantum dot as a function of dot sizes.

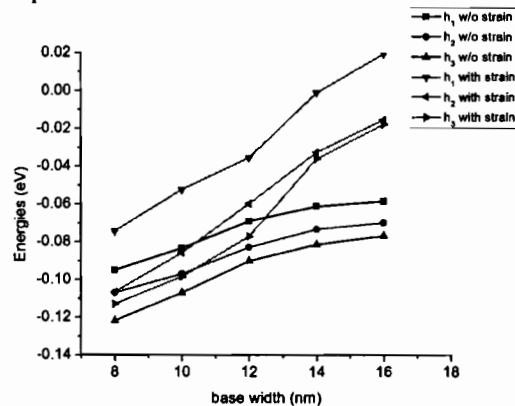


Figure 6. Hole energies of InAs/GaAs quantum dot as a function of dot sizes.

Finally the piezoelectricity (P_z) is examined. We consider the truncated pyramidal QD, $\text{base}_x = \text{base}_y = 10.0$ nm and height = 3.0 nm. The piezoelectric potential is included into the Hamiltonian. With the piezoelectricity, the electron and hole energies shift down about 10 meV which are very small compared to the strain field. The wave functions of electron and hole states are revealed as 2D plot along the x and y axis in Figure 7 and 8, respectively. The wave functions of QD are evaluated with and without the piezoelectric potential. The piezoelectric potential does not change the orientation of the s-electron states (e_1) as shown in Figure 7. In the p-electron states (e_2 and e_3), the piezoelectricity has flipped the orientations of wave functions from

[$1\bar{1}0$] to [110] and vice versa. The changes of the orientations also happen in the valence states of quantum dots because hole states consist of the linear combination of the p orbitals. The inclusion of the piezoelectricity into quantum dot introduces C_{2v} symmetry.

Table 1. Material parameters for the calculation.

	C_{11} (GPa)	C_{12} (GPa)	C_{44} (GPa)	e_{14} (C.m $^{-2}$)	ϵ
InAs	83.3	45.3	39.6	-0.115	14.6
GaAs	118.8	53.8	59.4	-0.230	13.18

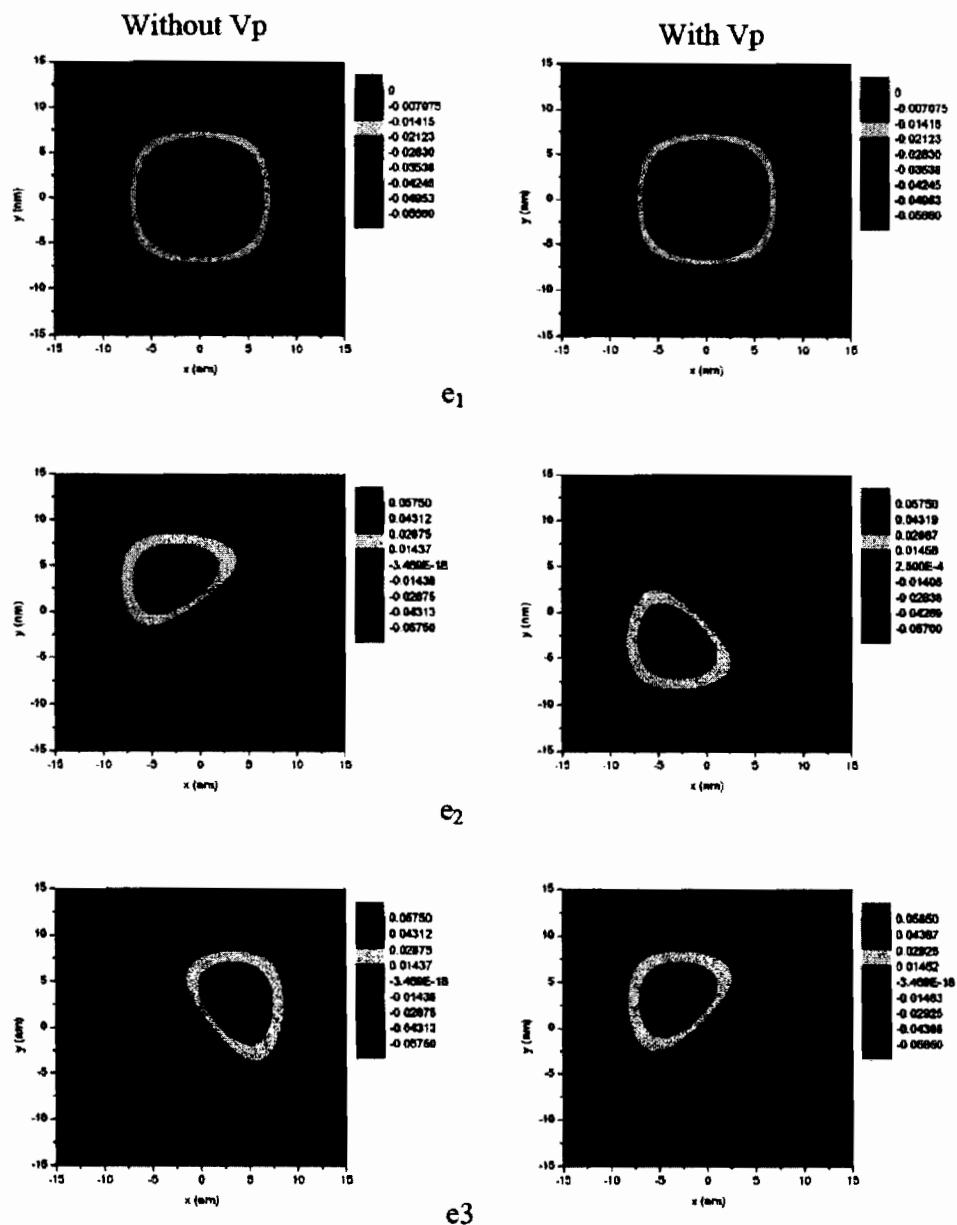


Figure 7. 2D plot of electron wave functions w/o and with the Piezoelectricity (Pz).

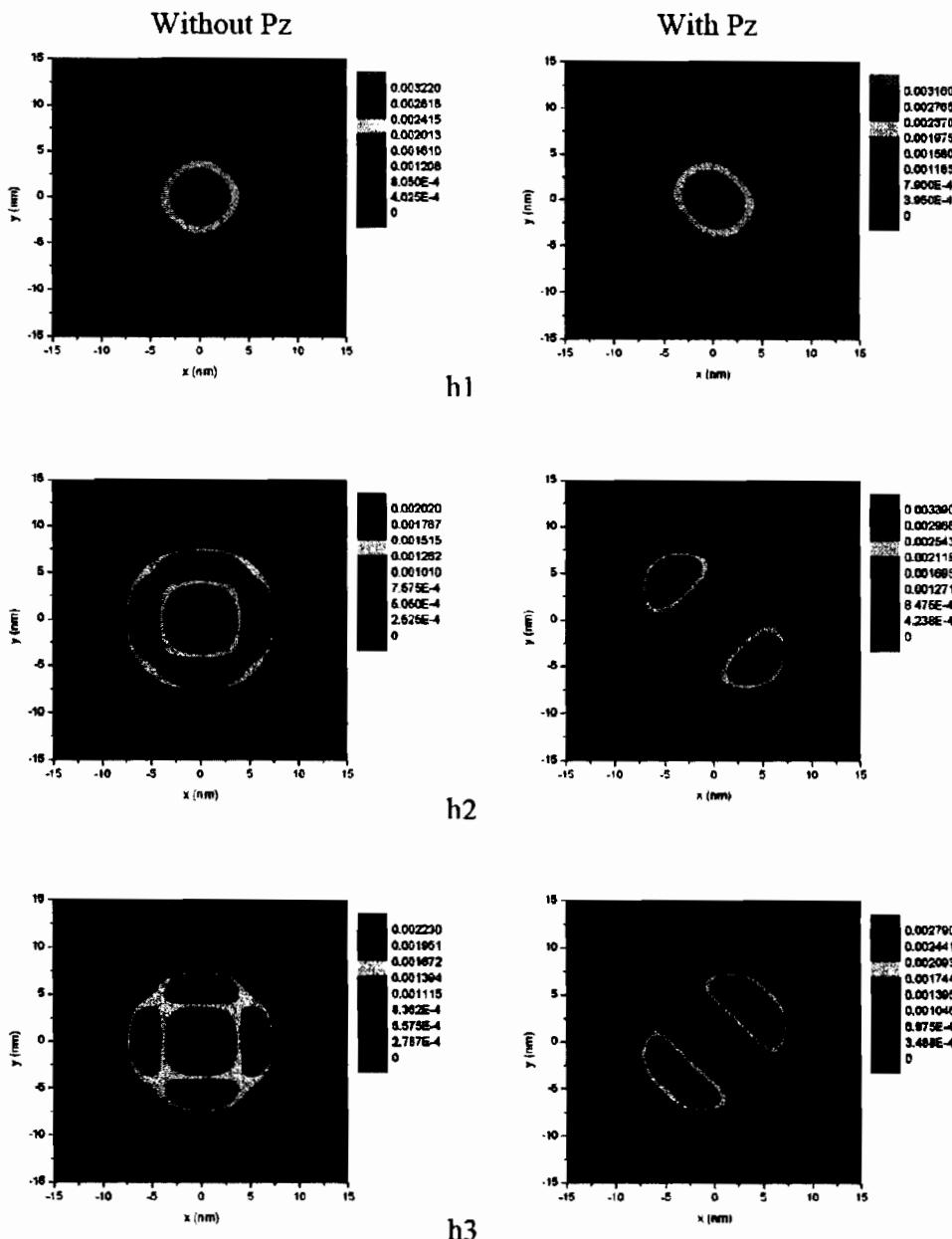


Figure 8. 2D plot of hole wave functions w/o and with the Piezoelectricity (Pz).

5. Conclusions

The effect of the strain and piezoelectricity of self-assembled InAs/GaAs quantum dots has been theoretically investigated by means of the continuum

elastic theory and k.p method. The calculated results show the importance of strain and piezoelectric effects on the electronic structure. The energies of electron and hole states including the strain effect are shifted into the high energy side in comparison with

ones excluding the strain effect. The piezoelectric potential does not change the orientation of the s-electron states (e_1), while the p-electron states (e_2 and e_3) flip the orientations of wave functions from [1̄10] to [110] and vice versa.

Acknowledgements

I would like to acknowledge Prof. Shun-Jen Cheng for k.p code and Ubon Ratchathani University for the grant.

References

- [1] M.A. Naser, M.J. Deen, D.A. Thompson. (2007). Spectral function and responsivity of resonant tunneling and superlattice quantum dot infrared photodetectors using Green's function. *J. Appl. Phys.*, 102, 083108.
- [2] V. Ryzhii, V. Mitin, M. Stroscio. (2001). On the detectivity of quantumdot infrared photodetectors. *Appl. Phys. Lett.*, 78, 3523.
- [3] Oliver Stier. (2000). Electronic and Optical Properties of Quantum Dots and Wires. *Wissenschaft & Technik Verlag*.
- [4] Worasak Sukkabot. (2010). Electronic Structure of Quantum Dot: Tight-Binding Approach. PhD Thesis, University of Surrey.
- [5] S. Fafard, K. Hinzer, S. Raymond, M. Dion. (1996). J. McCaffrey, Y. Feng, S. Charbonneau, Red-Emitting Semiconductor Quantum Dot Lasers. *Science*, 274, 1350.
- [6] Pilkyung Moon, Won Jun, Kwangmin Park, Euijoon Yoon, and JaeDong Lee. (2011). Anomalous strain profiles and electronic structures of a GaAs-capped InAs / In_{0.53}Ga_{0.47}As quantum ring. *J. Appl. Phys.*, 109, 103701.
- [7] S. I. Rybchenko, G. Yeap, R. Gupta, I. E. Itskevich, and S. K. Haywood. (2007). Importance of aspect ratio over shape in determining the quantization potential of self-assembled zinc-blende III-V quantum dots. *J. Appl. Phys.*, 102, 013706.
- [8] Beka Bochorishvili. (2011). Electronic states and oscillator strengths for interband transitions of a graded quantum dot quantum well structure. *Physica E.*, 43, 874–876.
- [9] C. Pryor, J. Kim, L. W. Wang, A. J. Williamson, and A. Zunger. (1998). Comparison of two methods for describing the strain profiles in quantum dots. *J. Appl. Phys.*, 83, 2548.
- [10] Zhao Wei, Yu Zhong-Yuan, and Liu Yu-Min. (2010). Piezoelectric effects and electronic structures of InAs/GaAs quantum dots grown along (111) and (011) directions. *Chin. Phys. B.*, 19, 067302.
- [11] Pilkyung Moon, Euijoon Yoon, Weidong Sheng, Jean-Pierre Leburton. (2009). Anisotropic enhancement of piezoelectricity in the optical properties of laterally coupled InAs/GaAs self-assembled quantum dots. *Phys. Rev. B.*, 79, 125325.
- [12] Gabriel Bester and Alex Zunger. (2005). Cylindrically shaped zinc-blende semiconductor quantum dots do not have cylindrical symmetry: Atomistic symmetry, atomic relaxation, and piezoelectric effects. *Phys. Rev. B.*, 71, 045318.
- [13] Stanko Tomic , Andrew G. Sunderland and Ian J. Bush .(2006). Parallel multi-band k.p code for electronic structure of zinc blend semiconductor quantum dots. *J. Mater. Chem.*, 16, 1963-1972.
- [14] J.Y. Marzin and G. Bastard. (1994). Calculation of the energy levels in InAs/GaAs quantum dots. *Solid State Commun.*, 92, 5437.
- [15] T. Saito and Y. Arakawa. (2002). Electronic Structure of Piezoelectric In_{0.2}Ga_{0.8}N Quantum Dots in GaN Calculated Using a Tight-Binding Method. *Physica E.* 15, 169.

- [16] Y. M. Niquet G. Allan and C. Delerue. (2000). Quantum confinement energies in zinc-blende IIIV and group IV semiconductors. *Appl. Phys. Lett.*, 77, 639.
- [17] Jeongnim Kim Lin-Wang Wang and Alex Zunger. (1999). Electronic structures of [110]-faceted self-assembled pyramidal InAs/GaAs quantum dots. *Phys. Rev. B.*, 59, 5678.
- [18] Hong Jiang, Harold U. Baranger and Weitao Yang. (2003). Density-functional theory simulation of large quantum dots. *Phys. Rev. B.*, 68, 165337.

Strain-induced band profile of stacked InAs/GaAs Quantum Dots**Worasak Sukkabot****Department of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, 85 Sathollmark Rd. Warinchamrab, Ubon Ratchathani, Thailand, 34190*

(Corresponding author's e-mail: w.sukkabot@gmail.com)

*Received: xxx, Revised: xxx, Accepted: xxx***Abstract**

We have calculated the strain distribution and band profile in triply stacked InAs/GaAs quantum dots (QDs) with the dot spacing 0.0-6.0 nm. We have used the continuum elasticity theory for the strain distribution and the eight-band k.p theory for the band structure. We report the use of the k.p method to calculate the band structure with and without including the effects of strain. The calculated results show the importance of strain effect on the confinement potential of the band structure for triply stacked InAs/GaAs quantum dots (QDs).

Keywords: Stacked quantum dots, strain distribution and k.p method**Introduction**

Research and development in semiconductor has seen progressive reduction in dimension, from bulk material to quantum well, then to quantum wire, and ultimately to quantum dot. Thus, the three-dimensional carrier confinement property can significantly lead to the superior characteristics of atom-like density-of-states (DOS), large exciton binding energies and enhanced oscillator strength in quantum dots. The quantum dots (QDs) can be the candidates in transistors, solar cells, LEDs, and diode lasers. They can be also represented as the agents for medical imaging and as possible qubits in quantum computing. Electronic structure and optical properties of semiconductor quantum dots have been intensively explored for more than two decades from the physical and technological interests to the zero-dimensional confined systems [1]. For example, the emission energy and carrier relaxation process in the 2-10-layer stacked InAs QDs with few-nm spacing have been studied in detail [2]. Recently vertically stacked InAs/GaAs quantum dots (QDs) have been investigated for the application to the quantum dot lasers and quantum computers [3]. Kita et al. [4, 5] experimentally demonstrated that the optical polarization can be controlled in the columnar InAs/GaAs quantum dots, in which the self-assembled QDs are vertically stacked with no inter-dot barrier layers. Saito et al. [3, 6] calculated the strain distribution and electronic structures in the stacked InAs/GaAs QDs with the dot spacing 0-6 nm; based on the elastic continuum theory and eight-band k.p theory. They also theoretically studied the optical polarization in columnar InAs/GaAs quantum dots. Janusz Andrzejewski et al. [7] presented the eight-band k.p calculations of the electronic and polarization properties for the columnar $In_xGa_{1-x}As$ quantum dots with high aspect ratio embedded in an $In_xGa_{1-x}As/GaAs$ quantum well. However, the previous studies have not investigated the dependence of dot spacing on the strain tensors and also the strain-induced band profile of the stacked quantum dots. The fundamental knowledge of this work can be implemented further to study the control of the polarization in stacked quantum dots that can be highly beneficial in some optoelectronic applications. According to the previous research, the stacked InAs/GaAs quantum dots with 0.0 nm spacing, generally called columnar QDs (CQDs) are significantly promising candidates for amplifier applications.

In order to understand the physical properties of the triply stacked quantum dots, theoretical calculations of the electronic structures based on the realistic strain distribution are essential. In this study, we calculate the strain distribution in the stacked InAs/GaAs quantum dots with the dot spacing in the range from 0 nm to 6 nm based on the continuum elasticity (CE) theory. The confinement potentials are numerically evaluated by means of the eight-band strain-dependent k.p theory. Finally, the band alignments are numerically evaluated with and without taking account into the strain field.

Theory

Strain Distribution

The atomic positions inside and around the quantum dot can be described in terms of the supercell of the Face-centered cubic structure. Due to the lattice mismatch between quantum dot and surrounding material, the atomic positions can change and the strain field also takes place in this structure. The continuum elasticity (CE) is determined to study this purpose. The total strain energy in the CE model is given by [3, 8, 9]:

$$U_{CE} = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} C_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl}$$

For a given structure, U_{CE} can be minimized by implementing the finite difference method for the strains $\varepsilon_{ij} = \left(\frac{du_i}{dx_j} + \frac{du_j}{dx_i} \right) / 2$, where u is the displacement vector field. The elastic moduli C_{ijkl} are represented by the parameters C_{11} , C_{12} and C_{44} for cubic crystals. Table I shows the material parameters [10] used for the calculations.

Eight-band strain-dependent k.p method

The influence of the strain profiles on the electronic structure of quantum dots has been previously investigated by implementing the strain-modified band offsets [11]. The strain-modified confinement potentials can be calculated by means of the eight-band strain-dependent k.p Hamiltonian, $H_k + H_s$, where H_k is the kinetic Hamiltonian and H_s is the strained Hamiltonian. The kinetic part of the total Hamiltonian is given by:

$$\begin{bmatrix} A & 0 & V^* & 0 & \sqrt{3}V & -\sqrt{2}U & -U & \sqrt{2}V^* \\ 0 & A & -\sqrt{2}U & -\sqrt{3}V^* & 0 & -V & \sqrt{2}V & U \\ V & -\sqrt{2}U & -P+Q & -S^* & R & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}S & -\sqrt{2}Q \\ 0 & -\sqrt{3}V & -S & -P+Q & 0 & R & -\sqrt{2}R & \frac{1}{\sqrt{2}}S \\ \sqrt{3}V^* & 0 & R^* & 0 & -P+Q & S^* & \frac{1}{\sqrt{2}}S^* & \sqrt{2}R^* \\ -\sqrt{2}U & -V^* & 0 & R^* & S & -P+Q & \sqrt{2}Q & \frac{\sqrt{3}}{2}S^* \\ -U & \sqrt{2}V^* & \frac{\sqrt{3}}{2}S^* & -\sqrt{2}R^* & \frac{1}{\sqrt{2}}S & \sqrt{2}Q & -P+\Delta & 0 \\ \sqrt{2}V & U & -\sqrt{2}Q & \frac{1}{\sqrt{2}}S^* & \sqrt{2}R & \frac{\sqrt{3}}{2}S & 0 & -P+\Delta \end{bmatrix}$$

Where

$$A = E_c - \frac{\hbar^2}{2m_0}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

$$B = E_v - \gamma_1 \frac{\hbar^2}{2m_0}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

$$Q = -\gamma_2 \frac{\hbar^2}{2m_0}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

$$R = \sqrt{3} \frac{\hbar^2}{2m_0} [\gamma_2(k_x^2 - k_y^2) - 2i\gamma_3 k_x k_y]$$

$$S = -\sqrt{3}\gamma_3 \frac{\hbar^2}{2m_0} k_z(k_x - ik_y)$$

$$U = \frac{-i}{\sqrt{3}} P_0 k_z$$

$$V = \frac{-i}{\sqrt{6}} P_0 (k_x - ik_y)$$

P_0 is the coupling between the conduction and valence bands, E_c and E_v are the unstrained conduction and valence band energy, respectively, and Δ is the spin-orbit splitting. The $\gamma_{i=1,2,3}$ are the modified Luttinger parameters defined in terms of the usual Luttinger parameters $\gamma_{i=1,2,3}^L$:

$$\gamma_1 = \gamma_L - \frac{E_p}{3E_g + \Delta}$$

$$\gamma_2 = \gamma_L - \frac{1}{2} \frac{E_p}{3E_g + \Delta}$$

$$\gamma_3 = \gamma_L - \frac{1}{2} \frac{E_p}{3E_g + \Delta}$$

$E_g = E_c - E_v$ is the energy gap and $E_p = 2m_0 P_0^2 / \hbar^2$. The strained part of the total Hamiltonian is also given by:

$$\begin{bmatrix} a_c e & 0 & -v^* & 0 & -\sqrt{3}v & \sqrt{2}u & u & -\sqrt{2}v^* \\ 0 & a_c e & \sqrt{2}u & \sqrt{3}v^* & 0 & v & -\sqrt{2}v & -u \\ -v & \sqrt{2}u & -p+q & -s^* & r & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}}s & -\sqrt{2}q \\ 0 & \sqrt{3}v & -s & -p+q & 0 & r & -\sqrt{2}r & \frac{1}{\sqrt{2}}s \\ -\sqrt{3}v^* & 0 & r^* & 0 & -p+q & s^* & \frac{1}{\sqrt{2}}s^* & \sqrt{2}r^* \\ \sqrt{2}u & v^* & 0 & r^* & s & -p+q & \sqrt{2}q & \sqrt{\frac{3}{2}}s^* \\ u & -\sqrt{2}v^* & \sqrt{\frac{3}{2}}s^* & -\sqrt{2}r^* & \frac{1}{\sqrt{2}}s & \sqrt{2}q & -p & 0 \\ -\sqrt{2}v & u & -\sqrt{2}q & \frac{1}{\sqrt{2}}s^* & \sqrt{2}r & \sqrt{\frac{3}{2}}s & 0 & -p \end{bmatrix}$$

Where

$$e = e_{xx} + e_{yy} + e_{zz}$$

$$p = a_v(e_{xx} + e_{yy} + e_{zz})$$

$$q = b[e_{zz} - \frac{1}{2}(e_{xx} + e_{yy})]$$

$$r = \frac{\sqrt{3}}{2} b(e_{xx} - e_{yy}) - i d e_{xy}$$

$$s = -d(e_{xz} - i e_{yz})$$

$$u = \frac{-i}{\sqrt{3}} P_0 \sum_j e_{xj} k_j$$

$$v = \frac{-i}{\sqrt{6}} P_0 \sum_j (e_{xj} - i e_{yj}) k_j$$

ϵ_{ij} is the strain tensor, b and d are the shear deformation potentials. a_v is the hydrostatic valence band deformation potential and a_c is the conduction-band deformation potential. Table II [11] lists the material parameters which are used to calculate the strain-induced confinement potentials.

After the total Hamiltonian ($H_k + H_s$) matrix elements are constructed, the matrix can be diagonalized by using the powerful eigenvalue solver called EISPACK library [12]. Finally, strain-induced band alignments are achieved.

Results and discussion

To investigate the influence of the strain field on the stacked InAs/GaAs quantum dots, recently there are various layers of the InAs dots (1-9) that have been studied in theory and experiment. In this work, the stacked quantum dot structures are modeled by triply vertically stacked InAs quantum dots embedded in GaAs surrounding material corresponding to the accessible range in the theoretical and experimental data. The growth direction is mainly aligned along the z axis. Each InAs quantum dot has a truncated pyramidal shape because of the realistic shape mostly fabricated in the experiments. The dot height is 3.0 nm and the length of the square base is 15.0 nm. The dot spacing varies from 0.0 to 6.0 nm. The cross-sectional view of the triply stacked quantum dot structures is depicted in Figure 1. The strain distribution in the stacked quantum dots can be evaluated using a finite difference method based on the continuum elasticity theory. This method has fruitfully implemented to single pyramidal quantum dots in the previous studies [13, 14].

To analyze the band profiles of the triply vertically stacked InAs/GaAs quantum dots as described in the section of Eight-band strain-dependent k.p method, the calculations of the hydrostatic and biaxial strains are mainly required. The hydrostatic $\epsilon_H = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}$ and biaxial $\epsilon_B = \epsilon_{zz} - (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})/2$ strains can determine the change of band confinement potential. The hydrostatic strains defined in the on-site diagonal term of H_s merely shift the energy levels of conduction and valence bands. While the biaxial strains defined in both of the on-site and off-site diagonal term of H_s intend to remove the degeneracy in the valence bands. Therefore, we numerically investigate the effect of the dot spacing on the hydrostatic and biaxial strains. Figure 2 illustrates the physical distribution of the hydrostatic and biaxial strain in the triply stacked InAs/GaAs quantum dots as a function of the dot spacings. The strain distribution along the z-axis (the line through the quantum dot center) is plotted. In the GaAs barrier regions, the hydrostatic strain is almost zero. In the quantum dot regions, the hydrostatic strain is approximately -0.08. The hydrostatic strain is mostly confined in the dots. The calculations demonstrate that there is compressive ($\epsilon_H < 0$) strain inside the quantum dot regions because GaAs surrounding material compresses the InAs dots. For 0.0 nm spacing, the biaxial strain is even smaller and eventually becomes negative in the middle of the stacked quantum dots. As increasing the spacing of the stack triply quantum dots, the biaxial strain in the quantum dot regions positively increases. This is due to the condition that the vertical lattice constant of InAs mis-match that of the side GaAs when the barriers are inserted to the triply stacked quantum dots. In the barriers, the biaxial strain is negative. With increasing the spacing, the biaxial strain gradually enhances.

After understanding the physical behaviors of the strain distribution, the strain tensors and deformation potentials can be numerically used to calculate the strain-induced confinement potentials for the triply stacked InAs/GaAs quantum dots. Based on the eight-band strain-dependent k.p method as described above, we compute the influences of the strain and dot spacing on the conduction band edge, the heavy-hole band edge, light-hole band edge and spin-orbit band edge as shown in Figure 3. In this model, we use the valence band offset between InAs/GaAs junction as +0.25 eV [9]. The confinement potentials are calculated with and without taking into account the strain effect. We find that the strain distribution can essentially modify the band profile in the stacked quantum dots. The numerical results demonstrate that the biaxial strain induces a different shift of degeneracy between the heavy hole and the

light hole band as compared to the unstrained band profile which are equated in the strained Hamiltonian (H_s) defined as the diagonal q term. In the conduction band (CB) the strain principally yields the rising confinement potentials in the dots, while confinement potentials in the barrier indifferently change. The enhancement and invariant of the conduction band (CB) can be caused from the hydrostatic strain (ε_H). In the heavy hole band (HH), the strain mainly elevates the confinement potentials in the dots, interface and the inter-dots, while ones in the barriers far way from dots unimportantly modify. In the light-hole (LH) and spin-orbit (SO) band, the strain mainly lowers the confinement potentials in the inter-dots and the interfaces, while ones in the dots and the barriers far way from dots insignificantly alter. From the strained-induced band profiles of the triply stacked quantum dots, the numerical data demonstrates that the energies of the confining electron and hole states mainly rise into the higher energies as compared to the unstrained band alignments. In term of the dot spacing, there is no alteration in the unstrained band profiles, while the strained ones are principally modified. The strained band alignments of both conduction and valence band in the dots unconcernedly change. However, the strained band profiles in the inter-dot regions modify. As increasing the dot spacing, strained potential confinements in the inter-dot zones become smooth and are close to unstrained ones because the coupling of the stacked quantum dots progressively reduces.

Conclusion

We have systematically discussed the strain distributions of triply vertically stacked InAs/GaAs quantum dots with the dot spacing ranging from 0.0 nm to 6.0 nm. First, based on the finite difference method, we calculate the strain distribution by means of the elastic continuum theory. Secondly, the strained-modified band edges are also calculated in the framework of the eight-band strain-dependent k.p method. The calculations demonstrate that there is compressive ($\varepsilon_H < 0$) strain in the quantum dot region. With increasing the dot spacing of the stack triply quantum dots, the biaxial strain in both of the quantum dot regions and barriers positively raises. The hydrostatic and biaxial strains are used to judge the change of band profiles. The hydrostatic strains shift the energy levels of conduction and valence bands, while the biaxial strains eliminate the degenerate valence bands. Finally, the strain distribution and dot spacings have the significant effect in modifying the band structure of stacked triply InAs/GaAs quantum dots.

Acknowledgements

This work has been supported by Ubon Ratchathani University.

References

- [1] M Grundmann. Nano-Optoelectronics: Concepts, Physics, and Devices. Springer-Verlag, New York, 2002, p. 167-199.
- [2] T Nakaoka, T Tatebayashi, and Y Arakawa. Spectroscopy on single columns of vertically aligned InAs quantum dots. *Physica E*. 2004; 21, 409-413.
- [3] T Saito, T Nakaoka, T Kakitsuka, Y Yoshikuni and Y Arakawa. Strain distribution and electronic states in stacked InAs/GaAs quantum dots with dot spacing 0-6 nm. *Physica E*. 2005; 26, 217-221.
- [4] T Kita, O Wada, H Ebe, Y Nakata and M Sugawara. Polarization-Independent Photoluminescence from Columnar InAs/GaAs Self-Assembled Quantum Dots. *Jpn. J. Appl. Phys.* 2002; 41, L1143-L1145.
- [5] T Kita, P Jayavel, O Wada, H Ebe, Y Nakata and M Sugawara. Polarization controlled edge emission from columnar InAs/GaAs self-assembled quantum dots. *Physica Status Solidi (C)*. 2003; 0, 1137-1140.
- [6] T Saito, H Ebe, Y Arakawa, T Kakitsuka and M Sugawara. Optical polarization in columnar InAs/GaAs quantum dots: 8-band k.p calculations. *Phys. Rev. B*. 2008; 77, 195318-195328.

- [7] Janusz Andrzejewski, Grzegorz Sek, Eoin O'Reilly, Andrea Fiore, and Jan Misiewicz. Eight-band $k\cdot p$ calculations of the composition contrast effect on the linear polarization properties of columnar quantum dots. *J. Appl. Phys.* 2010; 107, 073509-073520.
- [8] Oliver Stier. *Electronic and Optical Properties of Quantum Dots and Wires*. Wissenschaft & Technik Verlag, Germany, 2000, p. 35-40.
- [9] C Pryor, J Kim, LW Wang, AJ Williamson and A Zunger. Comparison of two methods for describing the strain profiles in quantum dots. *J. Appl. Phys.* 1998; 83, 2548-2554.
- [10] Zhao Wei, Yu Zhong-Yuan and Liu Yu-Min. Piezoelectric effects and electronic structures of InAs/GaAs quantum dots grown along (111) and (011) directions. *Chin. Phys. B.* 2010; 19, 067302-067305.
- [11] Craig Pryor. Eight-band calculations of strained InAs/GaAs quantum dots compared with one-, four-, and six-band approximations. *Phys. Rev. B.* 1998; 57, 7190-7195.
- [12] EISPACK, Available at: <http://www.netlib.org/eispack/>, accessed October 2012.
- [13] M Grundmann, O Stier and D Bimberg. InAs/GaAs pyramidal quantum dots: Strain distribution, optical phonons, and electronic structure. *Phys. Rev. B.* 1995; 52, 11969-11981.
- [14] T Nakaoka, T Kakitsuka, T Saito, S Kako, S Ishida, M Nishioka, Y Yoshikuni and Y Arakawa. Strain-induced modifications of the electronic states of InGaAs quantum dots. *J. Appl. Phys.* 2003; 94, 6812-6817.

Table I. Material parameters for the calculations.

	C ₁₁ (GPa)	C ₁₂ (GPa)	C ₄₄ (GPa)	e ₁₄ (C.m ⁻²)	ε
InAs	83.3	45.3	39.6	-0.115	14.6
GaAs	118.8	53.8	59.4	-0.230	13.18

Table II. Material parameters.

Parameters	InAs	GaAs
γ_1^L	19.67	6.85
γ_2^L	8.37	2.1
γ_3^L	9.29	2.9
E _g (eV)	0.418	1.519
Δ (eV)	0.38	0.33
E _p (eV)	22.2	25.7
a _c (eV)	-6.66	-8.6
a _v (eV)	0.66	-9.3
b(eV)	-1.8	0.7
d(eV)	-3.6	-2.0

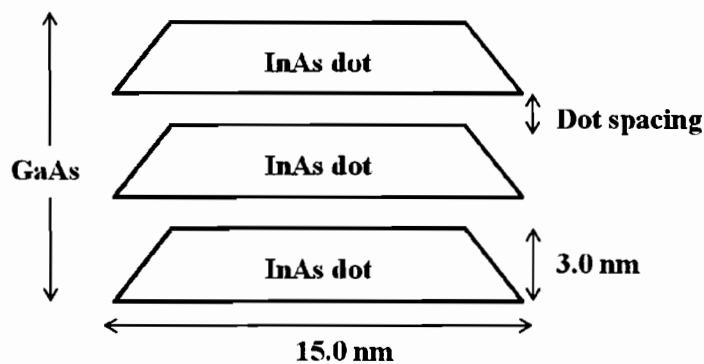


Figure 1 The cross-sectional picture of the triply stacked InAs/GaAs quantum dots.

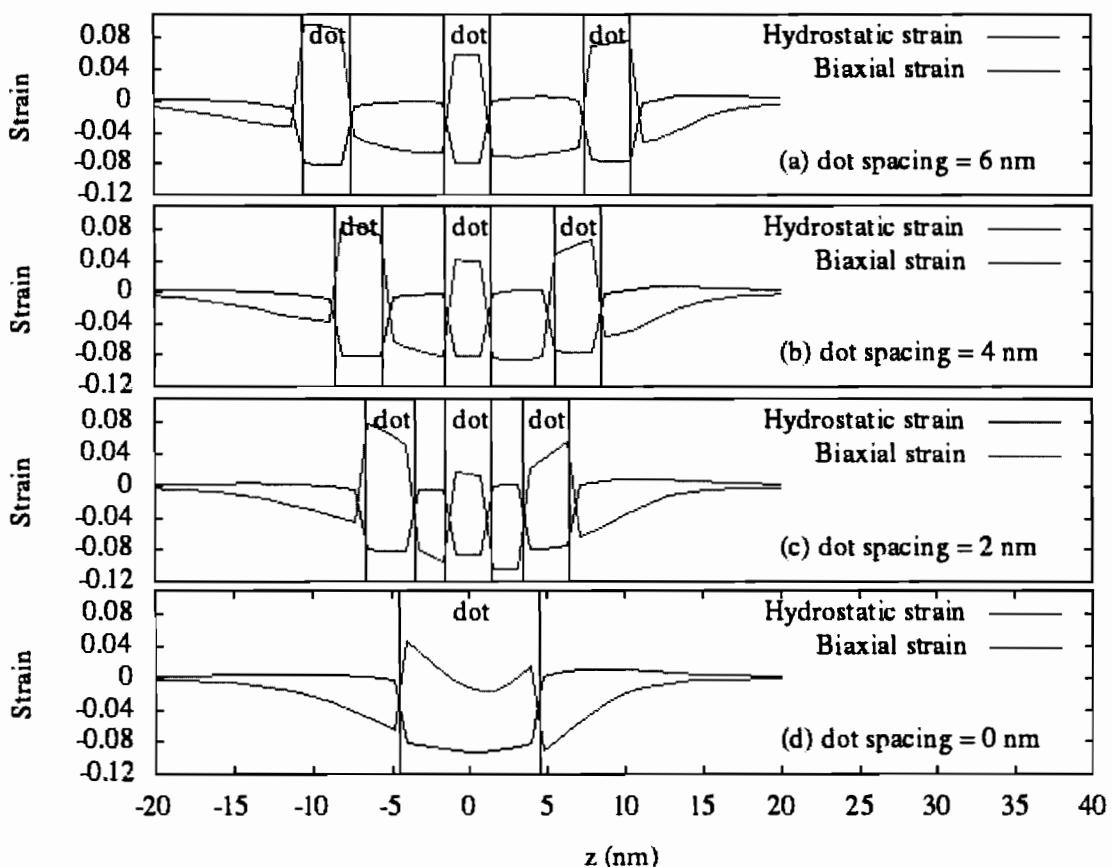


Figure 2 Strain distributions in the triply stacked InAs/GaAs quantum dots for the dot spacing; (a) 6 nm, (b) 4 nm, (c) 2 nm and (d) 0 nm.

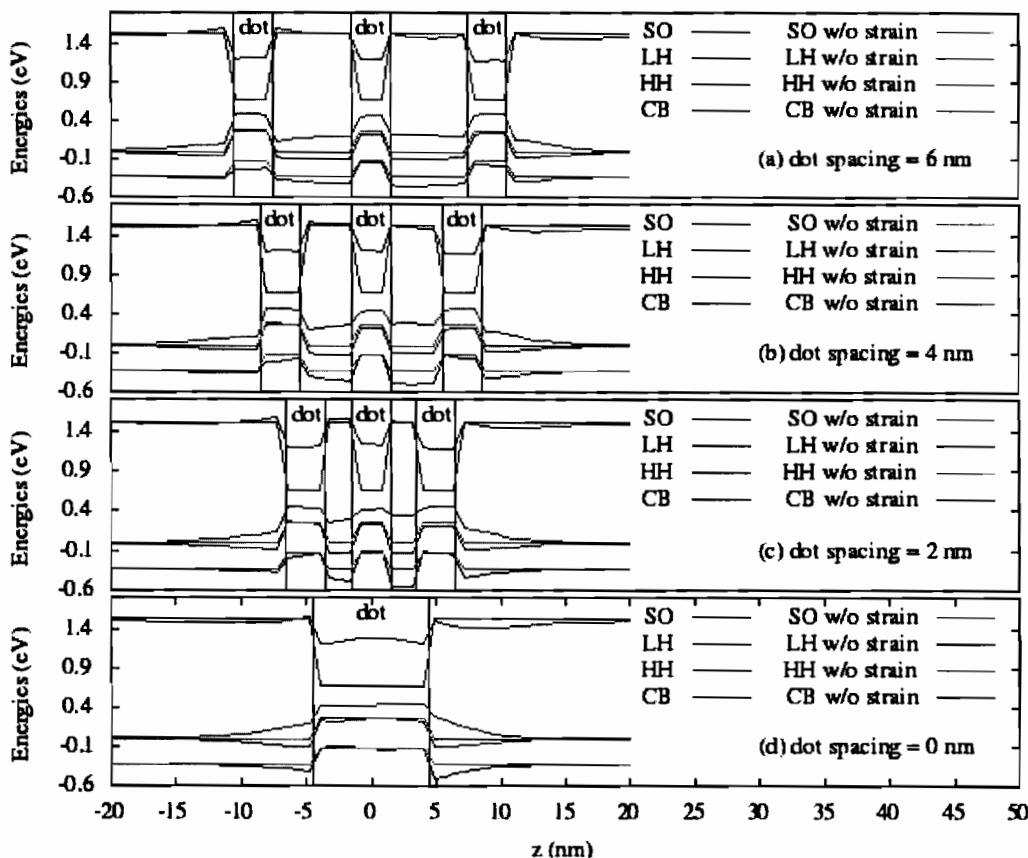


Figure 3 Strain-induced band profiles of the triply stacked InAs/GaAs quantum dots along the z direction for the dot spacing; (a) 6 nm, (b) 4 nm, (c) 2 nm and (d) 0 nm.

ภาคผนวก ข

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์

ภาคผนวก ๘

รายงานการเงิน

รายงานการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
- หัวหน้าโครงการวิจัย	9,000
ค่าใช้สอย	
- ค่าเดินทางในการไปสัมนาและเผยแพร่วิจัย	8,000
- หนังสือและเอกสารประกอบการวิจัย	7,100
ค่าวัสดุ	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,900
รวมงบประมาณที่เสนอขอ	45,000



ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์

กิจกรรม	ผลงานที่จะได้จากการ	สถานะ
1. ศึกษาการกระจายตัวของความเครียดภายในและรอบๆ ความตั้งคอกท	สมบัติการกระจายตัวของความเครียดเมื่อความตั้งคอกมีรูปร่างต่างๆ	สำเร็จ
2. ศึกษาปรากฏการณ์เพียงใด อิเล็กทรอนิกส์ของความตั้งคอก	เข้าใจคุณสมบัติของปรากฏการณ์เพียงใด อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อความตั้งคอก	สำเร็จ
3. คำนวณหาระดับพลังงานของสถานะ อิเล็กตรอนและโซลของความตั้งคอก	มีความรู้เกี่ยวกับระดับพลังงานภายในความตั้งคอก เมื่อความตั้งคอกมีรูปร่างและขนาดที่เปลี่ยนแปลงไป	สำเร็จ
4. ศึกษาและคำนวณสเปคตรัมการเปล่งแสงและการเปลี่ยนถ่ายระดับ พลังงานภายในอนุภาคความตั้งคอก	มีความรู้เกี่ยวกับสเปคตรัมการเปล่งแสงและการเปลี่ยนถ่ายระดับพลังงานภายในอนุภาคความตั้งคอกเมื่อความตั้งคอกมีรูปร่างและขนาดที่เปลี่ยนแปลงไป	สำเร็จ